



SEBASTIÁN ANTONIO BOTA FERRAGUT

Generat des de: Universitat de les Illes Balears

Data del document: 23/02/2021

v 1.4.0

9805560b4cc588d698d68b7a754ec694

Este fichero electrónico (PDF) contiene incrustada la tecnología CVN (CVN-XML). La tecnología CVN de este fichero permite exportar e importar los datos curriculares desde y hacia cualquier base de datos compatible. Listado de Bases de Datos adaptadas disponible en <http://cvn.fecyt.es/>



Resum lliure del currículum

Descripción breve de la trayectoria científica, los principales logros científico-técnicos obtenidos, los intereses y objetivos científico-técnicos a medio/largo plazo de la línea de investigación. Incluye también otros aspectos o peculiaridades importantes.

-

Sebastià Bota Ferragut és doctor en Física per la Universitat de Barcelona (1992), és professor Titular

d'Universitat des de 1995. Va ser investigador del Departament d'Electrònica de la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona des d'el 1988 fins al 2002. Des d'el 2002 és investigador del grup de recerca de Sistemes Electrònics del Departament de Física de la UIB. Té reconeguts cinc quinquennis de docència i tres sexennis d'investigació.

**SEBASTIÁN ANTONIO BOTA FERRAGUT**

Cognoms: **BOTA FERRAGUT**
Nom: **SEBASTIÁN ANTONIO**
DNI: **43016739T**
ORCID: **0000-0002-7653-0740**
ResearcherID: **F-2530-2013**
Data de naixement: **13/06/1964**
Sexe: **Home**
Nacionalitat: **Espanya**
País de naixement: **Espanya**
Ciutat de naixement: **Pollença (BALEARS)**
Adreça de contacte: **Carretera de Valldemossa KM 7.2**
Codi postal: **07122**
País de contacte: **Espanya**
Ciutat de contacte: **Palma**
Telèfon fix: **971259933 -**
Fax: **971173426**
Correu electrònic: **sebastia.bota@uib.es**

Situació professional actual, només si treballa (no situació d'atur)

Entitat ocupadora: Universidad de las Islas Baleares

Departament: Altres, Departament d'Enginyeria Industrial i Construcció

Categoria professional: Catedràtic/a d'universitat

Data d'inici: 13/09/2017

Modalitat del contracte: Funcionari/a

Tipus de dedicació: Temps complet

Primària (Codi UNESCO): 220307 - Circuits integrats

Secundària (Codi UNESCO): 330793 - Microelectrònica. disseny

Terciària (Codi UNESCO): 330703 - disseny de circuits

Funcions desenvolupades: OMPLIU LA DEDICACIÓ PROFESSIONAL A L'APARTAT DE TEXTOS DEL CURRÍCULUM

Càrrecs i activitats ocupats desenvolupats amb anterioritat

	Entitat ocupadora	Categoria professional	Data d'inici
1	Universidad de las Islas Baleares	Catedràtic d'universitat	13/09/2017
2	Universidad de las Islas Baleares	Professor titular d'Universitat	01/10/2002
3	Universitat de Barcelona	Professor titular d'Universitat	18/05/1995
4	Universitat de Barcelona	Prof. Titular Interino	01/10/1992
5	Universitat de Barcelona	Profesor Ayudante	01/06/1991
6	Universitat de Barcelona	Becario F.P.I.	01/01/1988

1

**C****V****n**

CURRÍCULUM VITAE NORMALIZADO

9805560b4cc588d698d68b7a754ec694

Entitat ocupadora: Universidad de las Islas Baleares**Categoria professional:** Catedràtic d'universitat**Data d'inici:** 13/09/2017**2 Entitat ocupadora:** Universidad de las Islas Baleares**Categoria professional:** Professor titular d'Universitat**Data d'inici:** 01/10/2002**Durada:** 14 anys - 11 mesos - 12 dies**3 Entitat ocupadora:** Universitat de Barcelona**Categoria professional:** Professor titular d'Universitat**Data d'inici:** 18/05/1995**Durada:** 7 anys - 4 mesos - 13 dies**4 Entitat ocupadora:** Universitat de Barcelona**Categoria professional:** Prof.Titular Interino**Data d'inici:** 01/10/1992**Durada:** 2 anys - 7 mesos - 17 dies**5 Entitat ocupadora:** Universitat de Barcelona**Categoria professional:** Profesor Ayudante**Data d'inici:** 01/06/1991**Durada:** 1 any - 4 mesos**6 Entitat ocupadora:** Universitat de Barcelona**Categoria professional:** Becario F.P.I.**Data d'inici:** 01/01/1988**Durada:** 3 anys - 4 mesos - 30 dies



Formació acadèmica rebuda

Titulació universitària

Estudis de primer i segon cicle i antics cicles (Llicenciats, Diplomats, Enginyers Superiors, Enginyers Tècnics, Arquitectes)

1 **Titulació universitària:** Diplomatura / Llicenciatura / Grau
Nom del títol: Master Cien.Materiales
Entitat de la titulació: Universitat de Barcelona
Data de la titulació: 12/1989

2 **Titulació universitària:** Diplomatura / Llicenciatura / Grau
Nom del títol: Física
Entitat de la titulació: Universitat de Barcelona
Data de la titulació: 06/1987

Doctorats

Doctorat: Física
Entitat de la titulació: Universitat de Barcelona
Data de la titulació: 06/1992
Tipus d'entitat: Universitat

Experiència docent

Direcció de tesis doctorals o projectes de fi de carrera

1 **Títol del treball:** A Contribution to the characterization of radiation-induced soft errors in sigma-delta modulators and SRAM memories
Tipus de projecte: Tesis doctoral
Universitat de l'entitat de realització: Universidad de las Islas Baleares
Ciutat de l'entitat de realització: Espanya
Alumne: Daniel Malagón Perianez
Qualificació obtinguda: Excel·lent
Data de lectura: 2018

2 **Títol del treball:** Estudio de eventos transitorios inducidos por radiación en memorias SRAM nanométricas
Tipus de projecte: Tesis doctoral
Universitat de l'entitat de realització: Universidad de las Islas Baleares
Ciutat de l'entitat de realització: Espanya
Alumne: Gabriel Torrens Caldentey
Qualificació obtinguda: Apte cum laude
Data de lectura: 2012

**3 Títol del treball:** Impacte de fenòmens transitoris deguts a radiació en memòries SRAM nanomètriques**Tipus de projecte:** Treball conduent a l'obtenció del DEA**Universitat de l'entitat de realització:** Universidad de las Islas Baleares**Ciutat de l'entitat de realització:** Espanya**Alumne:** Gabriel Torrens Caldentey**Qualificació obtinguda:** Excel·lent**Data de lectura:** 2009**4 Títol del treball:** Microelectronic Design of Pulse discriminators circuits for the LHCb detector**Tipus de projecte:** Tesi doctoral**Universitat de l'entitat de realització:** Barcelona**Ciutat de l'entitat de realització:** Espanya**Alumne:** David Gascón Fora**Qualificació obtinguda:** Excel·lent cum laude**Data de lectura:** 2008

Experiència científica i tecnològica

Activitat científica o tecnològica

Participació en projectes d'R+D+I finançats en convocatòries competitives d'Administracions d'entitats públiques o privades

1 Denominació del projecte: Plataformas CMOS-MEMS de bajo coste para aplicaciones de biosensado**Entitat de realització:** Universidad de las Islas Baleares**Tipus d'entitat:** Universitat**Ciutat de l'entitat de realització:** Espanya**Nom dels investigadors principals (IP, Co-IP...):** Jaume Verd Martorell**Nombre d'investigadors:** 8**Entitats de finançament:**

Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

Tipus d'entitat: Ministeris**Ciutat de l'entitat de finançament:** Espanya**Codi segons l'entitat de finançament:** TEC2017-88635-R**Data d'inici-fi:** 01/01/2018 - 31/12/2021**Durada:** 4 anys**Entitats participants:** Universitat de les Illes Balears**Quantia total:** 229.900 €**2 Denominació del projecte:** Explotación y escalado de características no-lineales de dispositivos

CMOS-M/NEMS monolíticos para aplicaciones específicas en aproximaciones 'More Moore' y 'More than Moore'. Acrónimo: KEYNEMS

Entitat de realització: Universidad de las Islas Baleares**Tipus d'entitat:** Universitat**Ciutat de l'entitat de realització:** Espanya**Nom dels investigadors principals (IP, Co-IP...):** Jaume Verd Martorell; Sebastián Antonio Bota Ferragut**Nombre d'investigadors:** 11**Entitats de finançament:**



Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) **Tipus d'entitat:** Ministeris
Ciutat de l'entitat de finançament: Espanya

Codi segons l'entitat de finançament: TEC2014-52878-R

Data d'inici-fi: 01/01/2015 - 31/12/2018

Durada: 4 anys

Entitats participants: Universitat de les Illes Balears

Quantia total: 207.152 €

- 3 Denominació del projecte:** Exploración de una propuesta tecnológica para la producción masiva y de bajo coste de monitores de glucosa no invasivos mediante sensores de acetona CMOS-MEMS

Entitat de realització: Universidad de las Islas Baleares

Tipus d'entitat: Universitat

Ciutat de l'entitat de realització: Espanya

Nom dels investigadors principals (IP, Co-IP...): Jaume Agapit Segura Fuster

Nombre d'investigadors: 5

Entitats de finançament:

Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)

Tipus d'entitat: Ministeris

Ciutat de l'entitat de finançament: Espanya

Codi segons l'entitat de finançament: TEC2014-61743-EXP

Data d'inici-fi: 01/09/2015 - 28/02/2017

Durada: 1 any - 6 mesos

Entitats participants: Universitat de les Illes Balears

Quantia total: 21.780 €

- 4 Denominació del projecte:** Red tematica en varibilidad en nanoelectronica (NANOVAR)

Entitat de realització: UIB y otras instituciones

Tipus d'entitat: Altres organismes

Ciutat de l'entitat de realització: Espanya

Nom dels investigadors principals (IP, Co-IP...): Montserrat Nafría Maqueda

Entitats de finançament:

Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)

Tipus d'entitat: Ministeris

Ciutat de l'entitat de finançament: Espanya

Codi segons l'entitat de finançament: TEC2014-53909-REDT

Data d'inici-fi: 01/12/2014 - 30/11/2016

Durada: 2 anys

Entitats participants: Universitat Autònoma de Barcelona

Quantia total: 20.000 €

- 5 Denominació del projecte:** Mitigación de eventos transitorios en circuitos CMOS nanométricos mediante parámetros estratégicos considerando variaciones estadísticas

Entitat de realització: Universidad de las Islas Baleares

Tipus d'entitat: Universitat

Ciutat de l'entitat de realització: Espanya

Nom dels investigadors principals (IP, Co-IP...): Sebastián Antonio Bota Ferragut

Nombre d'investigadors: 9

Entitats de finançament:

Ministerio de Ciencia e Innovación

Tipus d'entitat: Ministeris

Ciutat de l'entitat de finançament: Espanya

Codi segons l'entitat de finançament: TEC2011 25017

Data d'inici-fi: 01/01/2012 - 30/06/2015

Durada: 3 anys - 6 mesos

Entitats participants: Universitat de les Illes Balears

Quantia total: 145.805 €



- 6 Denominació del projecte:** Grup de Sistemes Electrònics
Entitat de realització: Universidad de las Islas Baleares **Tipus d'entitat:** Universitat
Ciutat de l'entitat de realització: Espanya
Nom dels investigadors principals (IP, Co-IP...): Jaume Agapit Segura Fuster
Nombre d'investigadors: 14
Entitats de finançament:
Conselleria d'Innovació, Interior i Justícia **Tipus d'entitat:** Administracions Públiques
Ciutat de l'entitat de finançament: Espanya
Codi segons l'entitat de finançament: 41/2011
Data d'inici-fi: 01/12/2011 - 30/11/2014 **Durada:** 3 anys
Entitats participants: Universitat de les Illes Balears
Quantia total: 36.000 €
- 7 Denominació del projecte:** Red española de variabilidad en tecnologías, circuitos y sistemas micro/nanoelectrónicos (VARIABLES)
Entitat de realització: UIB y otras instituciones **Tipus d'entitat:** Altres organismes
Ciutat de l'entitat de realització: Espanya
Nom dels investigadors principals (IP, Co-IP...): Montserrat Nafria Maqueda
Entitats de finançament:
Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) **Tipus d'entitat:** Ministeris
Ciutat de l'entitat de finançament: Espanya
Codi segons l'entitat de finançament: TEC2011-15599-E
Data d'inici-fi: 01/10/2011 - 30/09/2014 **Durada:** 3 anys
Entitats participants: Universitat Autònoma de Barcelona
Quantia total: 18.000 €
- 8 Denominació del projecte:** OPTIMISE:OPTImisation of Mltigations for Soft, firm and hard Errors
Entitat de realització: Universidad de las Islas Baleares **Tipus d'entitat:** Universitat
Ciutat de l'entitat de realització: Espanya
Nom dels investigadors principals (IP, Co-IP...): Jaume Agapit Segura Fuster
Entitats de finançament:
CATRENE (CA303) **Tipus d'entitat:** Altres organismes
Ciutat de l'entitat de finançament: Desconegut
Data d'inici-fi: 2010 - 2013 **Durada:** 3 anys - 1 dia
Entitats participants: Universitat de les Illes Balears
- 9 Denominació del projecte:** APOLO: Contribución española al proyecto OPTIMISE (CATRENE CA303)
Entitat de realització: Universidad de las Islas Baleares **Tipus d'entitat:** Universitat
Ciutat de l'entitat de realització: Espanya
Nom dels investigadors principals (IP, Co-IP...): Jaume Agapit Segura Fuster
Entitats de finançament:
Ministerio de Industria Turismo y Comercio **Tipus d'entitat:** Ministeris
Ciutat de l'entitat de finançament: Espanya
Codi segons l'entitat de finançament: PROFIT-TSI-020400-210-53
Data d'inici-fi: 2010 - 2013 **Durada:** 3 anys - 1 dia
Entitats participants: Universitat de les Illes Balears

10 Denominació del projecte: Sistema de emulación de partículas ionizantes en circuitos integrados mediante Laser

Entitat de realització: Universidad de las Islas Baleares

Tipus d'entitat: Universitat

Ciutat de l'entitat de realització: Espanya

Nom dels investigadors principals (IP, Co-IP...): Sebastián A. Bota Ferragut

Entitats de finançament:
MICINN

FEDER

Tipus d'entitat: Altres organismes

Ciutat de l'entitat de finançament: Desconegut

Codi segons l'entitat de finançament: UNBB08-4E-005

Data d'inici-fi: 2009 - 2011

Durada: 2 anys - 1 dia

Entitats participants: Universitat de les Illes Balears

Quantia total: 135.777 €

11 Denominació del projecte: ANALISIS DE FENOMENOS DINAMICOS HOSTILES EN TECNOLOGIAS CMOS NANOMETRICAS: APLICACION A DISEÑO Y TEST

Entitat de realització: Universidad de las Islas Baleares

Tipus d'entitat: Universitat

Ciutat de l'entitat de realització: Espanya

Nom dels investigadors principals (IP, Co-IP...): Jaume Segura Fuster

Nombre d'investigadors: 11

Entitats de finançament:

Ministerio de Ciencia e Innovación

Tipus d'entitat: Ministeris

Ciutat de l'entitat de finançament: Espanya

Codi segons l'entitat de finançament: TEC2008-04501/TEC

Data d'inici-fi: 2008 - 2011

Durada: 3 anys - 1 dia

Entitats participants: Universitat de les Illes Balears

Quantia total: 294.189 €

12 Denominació del projecte: APOLO - Participación española en el Proyecto OPTIMISE

Entitat de realització: Universidad de las Islas Baleares

Tipus d'entitat: Universitat

Ciutat de l'entitat de realització: Espanya

Nom dels investigadors principals (IP, Co-IP...): Jaume Agapit Segura Fuster

Nombre d'investigadors: 1

Entitats de finançament:

Ministerio de Industria Turismo y Comercio

Tipus d'entitat: Ministeris

Ciutat de l'entitat de finançament: Espanya

Codi segons l'entitat de finançament: TSI-020400-2009-17

Data d'inici-fi: 01/01/2009 - 31/03/2010

Durada: 1 any - 3 mesos

Entitats participants: Universitat de les Illes Balears

Quantia total: 31.332 €

13 Denominació del projecte: Tecnicas de test predictivas para circuitos integrados CMOS analógicos.

Entitat de realització: Universidad de las Islas Baleares

Tipus d'entitat: Universitat

Ciutat de l'entitat de realització: Espanya

Nom dels investigadors principals (IP, Co-IP...): Eugenio García Moreno



Nombre d'investigadors: 7

Entitats de finançament:

Ministerio de Educación y Ciencia

Tipus d'entitat: Ministeris

Ciutat de l'entitat de finançament: Espanya

Codi segons l'entitat de finançament: TEC2006-04103

Data d'inici-fi: 01/10/2006 - 30/09/2009

Durada: 3 anys

Entitats participants: Universitat de les Illes Balears

Quantia total: 96.800 €

- 14 Denominació del projecte:** Desenvolupament d'una metodologia estandaritzada per al disseny de xarxes de senso-actuadors: especificació a la gestió eficient de recursos a l'entorn de l'hoteleria

Entitat de realització: Universidad de las Islas Baleares

Tipus d'entitat: Universitat

Ciutat de l'entitat de realització: Espanya

Nom dels investigadors principals (IP, Co-IP...): José Luis Rosselló Sanz

Nombre d'investigadors: 7

Entitats de finançament:

Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació. Govern de les Illes Balears

Tipus d'entitat: Administracions Públiques

Ciutat de l'entitat de finançament: Espanya

Codi segons l'entitat de finançament: PROGECIB - 32 A

Data d'inici-fi: 01/04/2007 - 31/03/2009

Durada: 2 anys

Entitats participants: Universitat de les Illes Balears

Quantia total: 35.000 €

- 15 Denominació del projecte:** Analisis Estadístico de Parametros en Circuitos digitales CMOS Nanometricos: Aplicacion a métodos de Diseño y Test

Entitat de realització: Universidad de las Islas Baleares

Tipus d'entitat: Universitat

Ciutat de l'entitat de realització: Espanya

Nom dels investigadors principals (IP, Co-IP...): Jaume Agapit Segura Fuster

Nombre d'investigadors: 12

Entitats de finançament:

Ministerio de Educación y Ciencia

Tipus d'entitat: Ministeris

Ciutat de l'entitat de finançament: Espanya

Codi segons l'entitat de finançament: TEC2005-05712/MIC

Data d'inici-fi: 15/10/2005 - 14/10/2008

Durada: 3 anys

Entitats participants: Universitat de les Illes Balears

Quantia total: 166.005 €

- 16 Denominació del projecte:** PARACHUTE: Parasitic extraction and optimization for efficient microelectronic system design and application

Entitat de realització: Universidad de las Islas Baleares

Tipus d'entitat: Universitat

Ciutat de l'entitat de realització: Espanya

Nom dels investigadors principals (IP, Co-IP...): Jaume Agapit Segura Fuster

Nombre d'investigadors: 5

Entitats de finançament:

Ministerio de Industria y Energía

Tipus d'entitat: Altres organismes

Ciutat de l'entitat de finançament: Desconegut

**Codi segons l'entitat de finançament:** MEDEA+ (2A701)**Data d'inici-fi:** 2006 - 2007**Durada:** 1 any - 1 dia**Entitats participants:** Universitat de les Illes Balears**Quantia total:** 11.660 €

- 17 Denominació del projecte:** Contribución española al proyecto PARACHUTE
Entitat de realització: Universidad de las Islas Baleares **Tipus d'entitat:** Universitat
Ciutat de l'entitat de realització: Espanya
Nom dels investigadors principals (IP, Co-IP...): Jaume Segura Fuster
Nombre d'investigadors: 5
Entitats de finançament: Ministerio de Industria y Energía **Tipus d'entitat:** Altres organismes
Ciutat de l'entitat de finançament: Desconegut
Codi segons l'entitat de finançament: PROFIT
Data d'inici-fi: 2006 - 2007 **Durada:** 1 any - 1 dia
Entitats participants: Universitat de les Illes Balears

- 18 Denominació del projecte:** Sistema Autoguiado de Alta Fiabilidad Basado en Hardware Específico para Personas con Limitación Motriz (SAFHE)
Entitat de realització: Universidad de las Islas Baleares **Tipus d'entitat:** Universitat
Ciutat de l'entitat de realització: Espanya
Nom dels investigadors principals (IP, Co-IP...): Jaume Agapit Segura Fuster
Nombre d'investigadors: 12
Entitats de finançament: Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) **Tipus d'entitat:** Instituts
Ciutat de l'entitat de finançament: Espanya
Codi segons l'entitat de finançament: N° EXPEDIENTE 98 (2006)
Data d'inici-fi: 2006 - 2007 **Durada:** 1 any - 1 dia
Entitats participants: Universitat de les Illes Balears
Quantia total: 64.000 €

- 19 Denominació del projecte:** Desarrollo de nuevas estrategias de test para circuitos integrados CMOS RF (DET-CIRF)
Entitat de realització: Universidad de las Islas Baleares **Tipus d'entitat:** Universitat
Ciutat de l'entitat de realització: Espanya
Nom dels investigadors principals (IP, Co-IP...): Eugenio García Moreno
Nombre d'investigadors: 15
Entitats de finançament: Ministerio de Ciencia y Tecnología **Tipus d'entitat:** Ministeris
Ciutat de l'entitat de finançament: Espanya
Codi segons l'entitat de finançament: TIC2003-01075
Data d'inici-fi: 01/12/2003 - 30/11/2006 **Durada:** 3 anys
Entitats participants: Universitat de les Illes Balears
Quantia total: 197.800 €

20 Denominació del projecte: Estudio de la violación de CP con el detector LHCb
Entitat de realització: Universidad de las Islas Baleares **Tipus d'entitat:** Universitat
Ciutat de l'entitat de realització: Espanya
Nom dels investigadors principals (IP, Co-IP...): Luis Garrido Beltran
Entitats de finançament:
Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT) **Tipus d'entitat:** Altres organismes
Ciutat de l'entitat de finançament: Desconegut
Codi segons l'entitat de finançament: FPA2002-04452-C02-02
Data d'inici-fi: 2003 - 2005 **Durada:** 2 anys - 1 dia
Entitats participants: Universitat de les Illes Balears
Quantia total: 654.800 €

Contractes, convenis o projectes d'R+D+I, no competitiu amb Administracions o entitats públiques o privades

Denominació del projecte: Circuit Design for Low Temperature CMOS ICs
Grau de contribució: Investigador/a
Entitat de realització: Universidad de las Islas Baleares **Tipus d'entitat:** Universitat
Ciutat de l'entitat de realització: Espanya
Nom dels investigadors principals (IP, Co-IP...): Jaume Agapit Segura Fuster
Nombre d'investigadors: 5
Entitats participants: Universidad de las Islas Baleares
Entitats de finançament:
Microprocessor Research Laboratories, Intel Corporation **Tipus d'entitat:** Altres organismes
Ciutat de l'entitat de finançament: Desconegut
Data d'inici: 2002 **Durada:** 3 anys - 1 dia
Quantia total: 90.000 €

Resultats

Propietat intel·lectual i industrial

Títol de propietat industrial registrada: Dispositivo de caracterización de transitorios de corriente producidos por interacción de partículas ionizantes con un bloque de transistores de una puerta lógica
Tipus de propietat industrial: Patent d'invenió
Inventors/autors/obtentors: BOTA FERRAGUT, Sebastián Antonio; ALORDA LADARIA, Bartomeu; MERINO PANADES, José Luis; VERD MARTORELL, Jaume; ROSSELLO SANZ, José Luis; SEGURA FUSTER, Jaume Agapit
Entitat titular de drets: Universidad de las Islas Baleares
País d'inscripció: Espanya
Data de registre: 2009
Data de concessió: 2009
Nombre de patent: P200930030
Patent espanyola: Sí



Activitats científiques i tecnològiques

Producció científica

Publicacions, documents científics i tècnics

- 1** Daniel Malagón; Gabriel Torrens; Jaume Segura; Sebastià A. Bota. Single Event Upsets characterization of 65 nm CMOS 6T and 8T SRAM cells for ground level environment. Microelectronics Reliability. 110, pp. 1 - 8. (Regne Unit): 2020. Disponible en Internet en: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0026271419312429>>. ISSN 0026-2714
DOI: <https://doi.org/10.1016/j.microrel.2020.113696>
Tipus de producció: Artículo científico **Tipus de suport:** Revista
Posició de signatura: 4
Nombre total d'autors: 4
- 2** G. Torrens; A. Alheyasat; B. Alorda; S. Barceló; J. Segura; S. A. Bota. Transistor Width Effect on the Power Supply Voltage Dependence of α -SER in CMOS 6T SRAM. IEEE Transactions on Nuclear Science. 67 - 5, pp. 811 - 817. (Estats Units d'Amèrica): 2020. ISSN 0018-9499
DOI: <https://doi.org/10.1109/TNS.2020.2983586>
Tipus de producció: Artículo científico **Tipus de suport:** Revista
Posició de signatura: 6
Nombre total d'autors: 6
- 3** G. Torrens; B. Alorda; C. Carmona; D. Malagón-Periáñez; J. Segura; S.A. Bota. A 65-nm Reliable 6T CMOS SRAM Cell with Minimum Size Transistors. IEEE Transactions On Emerging Topics In Computing. 7 - 3, pp. 447 - 455. (Estats Units d'Amèrica): 2019. ISSN 2168-6750
DOI: <https://doi.org/10.1109/TETC.2017.2721932>
Tipus de producció: Artículo científico **Tipus de suport:** Revista
Posició de signatura: 6
Nombre total d'autors: 6
Font d'impacte: ISI **Categoria:** TELECOMMUNICATIONS
Índex d'impacte: 3.626 **Revista dins del 25%:** Sí
Posició de publicació: 10 **Nombre de revistes a la categoria:** 90
Font d'impacte: ISI **Categoria:** COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS
Índex d'impacte: 3.626 **Revista dins del 25%:** Sí
Posició de publicació: 8 **Nombre de revistes a la categoria:** 156
- 4** J. Barceló.; S. Bota; J. Segura; J. Verd. Nonlinear cc-beam microresonator model for system level electrical simulations: Application to bistable behavior analysis. Sensors and Actuators A-Physical. 272, pp. 33 - 41. (Suïssa): 2018. ISSN 0924-4247
Tipus de producció: Artículo científico **Tipus de suport:** Revista
Font d'impacte: ISI **Categoria:** ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC
Índex d'impacte: 2.739 **Revista dins del 25%:** No
Posició de publicació: 108 **Nombre de revistes a la categoria:** 265



Font d'impacte: ISI
Índex d'impacte: 2.739
Posició de publicació: 19

Categoria: INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION
Revista dins del 25%: No
Nombre de revistes a la categoria: 61

- 5** D.Malagón; S.A. Bota; G. Torrens; X. Gili; J. Praena; B. Fernández; M. Macías; J.M. Quesada; Carlos Guerrero Sanchez; M.C.Jiménez-Ramos; J.García López; J.L.Merino; J. Segura. Soft error rate comparison of 6T and 8T SRAM ICs using mono-energetic proton and neutron irradiation sources. Microelectronics Reliability. 78, pp. 38 - 45. (Regne Unit): 2017. Disponible en Internet en: <<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0026271417303852>>. ISSN 0026-2714

Tipus de producció: Artículo científico
Nombre total d'autors: 13

Tipus de suport: Revista

Font d'impacte: ISI

Categoria: ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC

Índex d'impacte: 1.236

Revista dins del 25%: No

Posició de publicació: 183

Nombre de revistes a la categoria: 260

Font d'impacte: ISI

Categoria: PHYSICS, APPLIED

Índex d'impacte: 1.236

Revista dins del 25%: No

Posició de publicació: 106

Nombre de revistes a la categoria: 146

Font d'impacte: ISI

Categoria: NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY

Índex d'impacte: 1.236

Revista dins del 25%: No

Posició de publicació: 81

Nombre de revistes a la categoria: 92

- 6** J. Barceló.; J.L. Rosselló; S. Bota; J. Segura; J. Verd. Electrostatically actuated microbeam resonators as chaotic signal generators: A practical perspective. Communications In Nonlinear Science And Numerical Simulation. 30, pp. 316 - 327. (Holanda): 2016. ISSN 1007-5704

Tipus de producció: Artículo científico

Tipus de suport: Revista

Font d'impacte: ISI

Categoria: MATHEMATICS, APPLIED

Índex d'impacte: 2,784

Revista dins del 25%: Sí

Posició de publicació: 9

Nombre de revistes a la categoria: 255

Font d'impacte: ISI

Categoria: MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS

Índex d'impacte: 2,784

Revista dins del 25%: Sí

Posició de publicació: 15

Nombre de revistes a la categoria: 100

Font d'impacte: ISI

Categoria: MECHANICS

Índex d'impacte: 2,784

Revista dins del 25%: Sí

Posició de publicació: 19

Nombre de revistes a la categoria: 133

Font d'impacte: ISI

Categoria: PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS

Índex d'impacte: 2,784

Revista dins del 25%: Sí

Posició de publicació: 7

Nombre de revistes a la categoria: 31

Font d'impacte: ISI

Categoria: PHYSICS, MATHEMATICAL

Índex d'impacte: 2,784

Revista dins del 25%: Sí

Posició de publicació: 2

Nombre de revistes a la categoria: 55

- 7** Bartomeu Alorda; Cristian Carmona; Gabriel Torrens; Sebastia Bota. An affordable experimental technique for SRAM write margin characterization for nanometer CMOS technologies. Microelectronics Reliability. 65, pp. 280 - 288. (Regne Unit): 2016. Disponible en Internet en: <<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0026271416303067>>. ISSN 0026-2714
DOI: <https://doi.org/10.1016/j.microrel.2016.07.154>
Tipus de producció: Article científico
Tipus de suport: Revista
Nombre total d'autors: 4
Categoria: ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC
Font d'impacte: ISI
Revista dins del 25%: No
Índex d'impacte: 1.371
Nombre de revistes a la categoria: 262
Posició de publicació: 158
Categoria: PHYSICS, APPLIED
Revista dins del 25%: No
Nombre de revistes a la categoria: 148
Font d'impacte: ISI
Categoria: NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY
Índex d'impacte: 1.371
Revista dins del 25%: No
Posició de publicació: 68
Nombre de revistes a la categoria: 87
- 8** Bota, S.A.; Torrens, G.; Verd, J.; Segura, J. Detailed 8-transistor SRAM cell analysis for improved alpha particle radiation hardening in nanometer technologies. Solid-State Electronics. 111 - September, pp. 104 - 110. (Estats Units d'Amèrica): 2015. Disponible en Internet en: <<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038110115001689>>. ISSN 0038-1101
DOI: <https://doi.org/10.1016/j.sse.2015.05.036>
Tipus de producció: Article científico
Tipus de suport: Revista
Posició de signatura: 1
Categoria: ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC
Nombre total d'autors: 4
Revista dins del 25%: No
Font d'impacte: ISI
Nombre de revistes a la categoria: 257
Índex d'impacte: 1.504
Categoria: PHYSICS, APPLIED
Posició de publicació: 119
Revista dins del 25%: No
Nombre de revistes a la categoria: 145
Font d'impacte: ISI
Categoria: PHYSICS, CONDENSED MATTER
Índex d'impacte: 1.504
Revista dins del 25%: No
Posició de publicació: 45
Nombre de revistes a la categoria: 67
- 9** S.A. Bota; G. Torrens; J. Verd; J.L. Merino; D. Malagon-Perianez; J. Segura. Memory State Transient Analysis (MSTA): A New Soft Error Rate Measurement Method for CMOS Memory Elements Based on Stochastic Analysis. IEEE Transactions on Nuclear Science. 62 - 6, pp. 3353 - 3361. (Estats Units d'Amèrica): 2015. Disponible en Internet en: <<http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=7348993&isnumber=7348739>>. ISSN 0018-9499
Tipus de producció: Article científico
Tipus de suport: Revista
Posició de signatura: 1
Categoria: ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC
Nombre total d'autors: 6
Revista dins del 25%: No
Font d'impacte: ISI
Índex d'impacte: 1.198

**Posició de publicació:** 136**Font d'impacte:** ISI**Índex d'impacte:** 1.198**Posició de publicació:** 10**Nombre de revistes a la categoria:** 257**Categoria:** NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY**Revista dins del 25%:** No**Nombre de revistes a la categoria:** 32

- 10** Barcelo, S.; Gili, X.; Bota, S.; Segura, J. Sensitization Input Vector Impact on Propagation Delay for Nanometer CMOS ICs: Analysis and Solutions. IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (vlsi) Systems. 22 - 7, pp. 1557 - 1569. (Estats Units d'Amèrica): 2014. ISSN 1063-8210

DOI: <https://doi.org/10.1109/TVLSI.2013.2276738>**Tipus de producció:** Artículo científico**Nombre total d'autors:** 4**Font d'impacte:** ISI**Índex d'impacte:** 1.356**Posició de publicació:** 111**Font d'impacte:** ISI**Índex d'impacte:** 1.356**Posició de publicació:** 16**Tipus de suport:** Revista**Categoria:** ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC**Revista dins del 25%:** No**Nombre de revistes a la categoria:** 249**Categoria:** COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE**Revista dins del 25%:** No**Nombre de revistes a la categoria:** 50

- 11** Torrens, G.; de Paul, I.; Alorda, B.; Bota, S.; Segura, J. SRAM alpha-SER estimation from word-line voltage margin measurements: design architecture and Experimental Results. IEEE Transactions on Nuclear Science. 61 - 4, pp. 1849 - 1855. (Estats Units d'Amèrica): 2014. ISSN 0018-9499

DOI: <https://doi.org/10.1109/TNS.2014.2311697>**Tipus de producció:** Artículo científico**Posició de signatura:** 4**Nombre total d'autors:** 5**Font d'impacte:** ISI**Índex d'impacte:** 1.283**Posició de publicació:** 120**Font d'impacte:** ISI**Índex d'impacte:** 1.283**Posició de publicació:** 6**Tipus de suport:** Revista**Categoria:** ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC**Revista dins del 25%:** No**Nombre de revistes a la categoria:** 249**Categoria:** NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY**Revista dins del 25%:** Sí**Nombre de revistes a la categoria:** 34

- 12** Alorda, B.; Torrens, G.; Bota, S.; Segura, J. Adaptive static and dynamic noise margin improvement in minimum-sized 6T-SRAM cells. Microelectronics Reliability. 54 - 11, pp. 2613 - 2620. (Regne Unit): 2014. Disponible en Internet en: <<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0026271414001772>>. ISSN 0026-2714

DOI: <https://doi.org/10.1016/j.microrel.2014.05.009>**Tipus de producció:** Artículo científico**Posició de signatura:** 3**Nombre total d'autors:** 4**Font d'impacte:** ISI**Índex d'impacte:** 1.433**Posició de publicació:** 107**Font d'impacte:** ISI**Tipus de suport:** Revista**Categoria:** ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC**Revista dins del 25%:** No**Nombre de revistes a la categoria:** 249**Categoria:** PHYSICS, APPLIED



Índex d'impacte: 1.433
Posició de publicació: 82

Font d'impacte: ISI
Índex d'impacte: 1.433
Posició de publicació: 55

Revista dins del 25%: No
Nombre de revistes a la categoria: 144

Categoria: NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY
Revista dins del 25%: No
Nombre de revistes a la categoria: 80

- 13** Torrens, G.; Bota, S.; Alorda, B.; Segura, J. An Experimental approach to accurate alpha-SER modeling and optimization through design parameters in 6T SRAM cells for deep-nanometer CMOS. Ieee Transactions On Device And Materials Reliability. 14 - 4, pp. 1013 - 1021. (Estats Units d'Amèrica): 2014. Disponible en Internet en: <<http://ieeexplore.ieee.org/xpls/icp.jsp?arnumber=6909029>>. ISSN 1530-4388

DOI: <https://doi.org/10.1109/TDMR.2014.2360035>

Tipus de producció: Artículo científico

Tipus de suport: Revista

Posició de signatura: 2

Nombre total d'autors: 4

Font d'impacte: ISI

Categoria: ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC

Índex d'impacte: 1.89

Revista dins del 25%: No

Posició de publicació: 69

Nombre de revistes a la categoria: 249

Font d'impacte: ISI

Categoria: PHYSICS, APPLIED

Índex d'impacte: 1.89

Revista dins del 25%: No

Posició de publicació: 53

Nombre de revistes a la categoria: 144

- 14** Gili, X.; Barcelo, S.; Bota, S. A.; Segura, J. Analytical Modeling of Single Event Transients Propagation in Combinational Logic Gates. IEEE Transactions on Nuclear Science. 59 - 4, pp. 971 - 979. (Estats Units d'Amèrica): 2012. ISSN 0018-9499

Tipus de producció: Artículo científico

Tipus de suport: Revista

Nombre total d'autors: 4

Font d'impacte: ISI

Categoria: ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC

Índex d'impacte: 1.219

Revista dins del 25%: No

Posició de publicació: 110

Nombre de revistes a la categoria: 243

Font d'impacte: ISI

Categoria: NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY

Índex d'impacte: 1.219

Revista dins del 25%: Sí

Posició de publicació: 8

Nombre de revistes a la categoria: 34

- 15** Villacorta, H.; Champac, V.; Bota, S.; Segura, J. Resistive bridge defect detection enhancement under parameter variations combining Low VDD and body bias in a delay based test. Microelectronics Reliability. 52 - 11, pp. 2799 - 2804. (Regne Unit): 2012. Disponible en Internet en: <<http://dx.doi.org/10.1016/j.microrel.2012.04.001>>. ISSN 0026-2714

DOI: <https://doi.org/10.1016/j.microrel.2012.04.001>

Tipus de producció: Artículo científico

Tipus de suport: Revista

Font d'impacte: ISI

Categoria: ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC

Índex d'impacte: 1.137

Revista dins del 25%: No

Posició de publicació: 119

Nombre de revistes a la categoria: 243

Font d'impacte: ISI

Categoria: PHYSICS, APPLIED

Índex d'impacte: 1.137

Revista dins del 25%: No

Posició de publicació: 78

Nombre de revistes a la categoria: 128



Font d'impacte: ISI
Índex d'impacte: 1.137
Posició de publicació: 51

Categoria: NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY
Revista dins del 25%: No
Nombre de revistes a la categoria: 69

- 16** Merino, J.L.; Bota, S.A.; Picos, R.; Segura, J. Alternate characterization technique for static random-access memory static noise margin determination. International Journal of Circuit Theory and Applications. 41 - 10, pp. 1085 - 1096. (Regne Unit): 2012. Disponible en Internet en: <<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cta.1832/full>>. ISSN 0098-9886

DOI: <https://doi.org/10.1002/cta.1832>
Tipus de producció: Artículo científico
Nombre total d'autors: 4

Tipus de suport: Revista

Font d'impacte: ISI

Categoria: ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC

Índex d'impacte: 1.293
Posició de publicació: 102

Revista dins del 25%: No
Nombre de revistes a la categoria: 243

- 17** Alorda, B.; Torrens, G.; Bota, S.A.; Segura, J. 8T vs. 6T SRAM cell radiation robustness: A comparative analysis. Microelectronics Reliability. 51 - 2, pp. 350 - 359. (Regne Unit): 2011. ISSN 0026-2714

DOI: <https://doi.org/10.1016/j.microrel.2010.09.002>

Tipus de producció: Artículo científico
Posició de signatura: 3
Nombre total d'autors: 4

Tipus de suport: Revista

Font d'impacte: ISI

Categoria: ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC

Índex d'impacte: 1.066
Posició de publicació: 112

Revista dins del 25%: No
Nombre de revistes a la categoria: 245

Font d'impacte: ISI
Índex d'impacte: 1.066
Posició de publicació: 71

Categoria: PHYSICS, APPLIED
Revista dins del 25%: No
Nombre de revistes a la categoria: 124

Font d'impacte: ISI
Índex d'impacte: 1.066
Posició de publicació: 47

Categoria: NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY
Revista dins del 25%: No
Nombre de revistes a la categoria: 66

- 18** Gascoón, D.; Bota, S.; Diéguez, A.; Garrido, L.; Picatoste, E. Noise analysis of time variant shapers in frequency domain. IEEE Transactions on Nuclear Science. 58 - 1, pp. 177 - 186. (Estats Units d'Amèrica): 2011. ISSN 0018-9499

Tipus de producció: Artículo científico
Posició de signatura: 2
Nombre total d'autors: 5
Font d'impacte: ISI

Tipus de suport: Revista

Índex d'impacte: 1.45
Posició de publicació: 84

Categoria: ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC
Revista dins del 25%: No
Nombre de revistes a la categoria: 245

Font d'impacte: ISI
Índex d'impacte: 1.45
Posició de publicació: 8

Categoria: NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY
Revista dins del 25%: Sí
Nombre de revistes a la categoria: 35



- 19** Torrens, G.; Alorda, B.; Barcelo, S.; Rossello, J.L.; Bota, S.A.; Segura, J. Design Hardening of Nanometer SRAMs Through Transistor Width Modulation and Multi-Vt Combination. Ieee Transactions On Circuits And Systems Li-Express Briefs. 57 - 4, pp. 280 - 284. (Estats Units d'Amèrica): 2010. ISSN 1549-7747
DOI: <https://doi.org/10.1109/TCSII.2010.2043462>
Tipus de producció: Artículo científico
Tipus de suport: Revista
Posició de signatura: 5
Categoria: ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC
Nombre total d'autors: 6
Revista dins del 25%: No
Font d'impacte: ISI
Nombre de revistes a la categoria: 247
Índex d'impacte: 1.334
Posició de publicació: 93
- 20** Suenaga, K.; Isern, E.; Picos, R.; Bota, S.; Roca, M.; Garcia-Moreno, E. Application of Predictive Oscillation-Based Test to a CMOS OpAmp. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. 59 - 8, pp. 2076 - 2082. (Estats Units d'Amèrica): 2010. ISSN 0018-9456
DOI: <https://doi.org/10.1109/TIM.2009.2031381>
Tipus de producció: Artículo científico
Tipus de suport: Revista
Nombre total d'autors: 6
Categoria: ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC
Font d'impacte: ISI
Revista dins del 25%: No
Índex d'impacte: 1.025
Nombre de revistes a la categoria: 247
Posició de publicació: 111
Categoria: INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION
Font d'impacte: ISI
Revista dins del 25%: No
Índex d'impacte: 1.025
Nombre de revistes a la categoria: 61
Posició de publicació: 29
- 21** García-Moreno, E.; Picos, R.; Isern, E.; Roca, M.; Bota, S.; Suenaga, K. Radiation Sensor Compatible with Standard CMOS technology. IEEE Transactions on Nuclear Science. 56 - 5, pp. 2910 - 2915. (Estats Units d'Amèrica): 2009. ISSN 0018-9499
DOI: <https://doi.org/10.1109/TNS.2008.2011804>
Tipus de producció: Artículo científico
Tipus de suport: Revista
Nombre total d'autors: 6
Categoria: ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC
Font d'impacte: ISI
Revista dins del 25%: No
Índex d'impacte: 1.591
Nombre de revistes a la categoria: 246
Posició de publicació: 68
Categoria: NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY
Font d'impacte: ISI
Revista dins del 25%: Sí
Índex d'impacte: 1.591
Nombre de revistes a la categoria: 33
Posició de publicació: 4
- 22** García-Moreno, E.; Suenaga, K.; Picos, R.; Bota, S.; Roca, M.; Isern, E. Predictive test strategy for CMOS RF mixers. Integration-the Vlsi Journal. 42 - 1, pp. 95 - 102. (Holanda): 2009. ISSN 0167-9260
DOI: <https://doi.org/10.1016/j.vlsi.2008.09.008>
Tipus de producció: Artículo científico
Tipus de suport: Revista
Nombre total d'autors: 6
Categoria: ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC
Font d'impacte: ISI
Revista dins del 25%: No
Índex d'impacte: 0.659
Nombre de revistes a la categoria: 246
Posició de publicació: 157



Font d'impacte: ISI

Índex d'impacte: 0.659

Posició de publicació: 34

Categoria: COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE

Revista dins del 25%: No

Nombre de revistes a la categoria: 49

- 23** Rosselló, J.L.; Canals, V.; de Paúl, I.; Bota, S.A.; Morro, A. A simple CMOS chaotic integrated circuit. *Icice Electronics Express*. 5 - 24, pp. 1042 - 1048. (Japó): 2008. ISSN 1349-2543

DOI: <https://doi.org/10.1587/ELEX.5.1042>

Tipus de producció: Artículo científico

Nombre total d'autors: 5

Font d'impacte: ISI

Índex d'impacte: 0.482

Posició de publicació: 170

Tipus de suport: Revista

Categoria: ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC

Revista dins del 25%: No

Nombre de revistes a la categoria: 229

- 24** The LHCb Collaboration. The LHCb Detector at the LHC. *Journal Of Instrumentation*. 3 - August, pp. 1 - 205. (Regne Unit): 2008. Disponible en Internet en:

<http://iopscience.iop.org/1748-0221/3/08/S08005/pdf/1748-0221_3_08_S08005.pdf>. ISSN 1748-0221

DOI: <https://doi.org/10.1088/1748-0221/3/08/S08005>

Tipus de producció: Artículo científico

Posició de signatura: 48

Nombre total d'autors: 910

Font d'impacte: ISI

Índex d'impacte: 0.821

Posició de publicació: 50

Tipus de suport: Revista

Categoria: INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION

Revista dins del 25%: No

Nombre de revistes a la categoria: 56

Font de citació: WOS

Citacions: 43

- 25** Roca, M.; Isern, E.; Picos, R.; Bota, S.; Suenaga, K.; Garcia-Moreno, E. Accuracy evaluation in parameter prediction of analogue circuits using nonlinear oscillation methods. *Electronics Letters*. 43 - 9, pp. 494 - 496. (Regne Unit): 2007. ISSN 0013-5194

DOI: <https://doi.org/10.1049/el:20070269>

Tipus de producció: Artículo científico

Nombre total d'autors: 6

Font d'impacte: ISI

Índex d'impacte: 1.009

Posició de publicació: 86

Tipus de suport: Revista

Categoria: ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC

Revista dins del 25%: No

Nombre de revistes a la categoria: 227

- 26** Suenaga, K.; Picos, R.; Bota, S.; Roca, M.; Isern, E.; Garcia-Moreno, E. A module for BIST of CMOS RF Receivers. *Journal of Electronic Testing-Theory and Applications*. 23 - 6, pp. 605 - 612. (Estats Units d'Amèrica): 2007. ISSN 0923-8174

DOI: <https://doi.org/10.1007/s10836-007-5051-1>

Tipus de producció: Artículo científico

Font d'impacte: ISI

Índex d'impacte: 0.238

Posició de publicació: 180

Tipus de suport: Revista

Categoria: ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC

Revista dins del 25%: No

Nombre de revistes a la categoria: 227



- 27** Gómez, J.M.; Bota, S.A.; Marco, S.; Samitier, J. Force-balance interface circuit based on floating MOSFET capacitors for micro-machined capacitive accelerometers. *Ieee Transactions On Circuits And Systems Ii-Express Briefs*. 53 - 7, pp. 546 - 552. (Estats Units d'Amèrica): 2006. ISSN 1549-7747
DOI: <https://doi.org/10.1109/TCSII.2006.875315>
Tipus de producció: Artículo científico **Tipus de suport:** Revista
Nombre total d'autors: 4
Font d'impacte: ISI **Categoria:** ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC
Índex d'impacte: 0.922 **Revista dins del 25%:** No
Posició de publicació: 80 **Nombre de revistes a la categoria:** 202
- 28** Bota, S.A.; Rosselló, J.; de Benito, C; Keshavarzi, A.; Segura, J. Impact of thermal gradients on clock skew and testing. *IEEE Design & Test of Computers*. 23 - 5, pp. 414 - 424. (Estats Units d'Amèrica): 2006. ISSN 0740-7475
Tipus de producció: Artículo científico **Tipus de suport:** Revista
Nombre total d'autors: 5
Font d'impacte: ISI **Categoria:** COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE
Índex d'impacte: 0.843 **Revista dins del 25%:** No
Posició de publicació: 18 **Nombre de revistes a la categoria:** 44
- 29** Rosselló, J.; de Benito, C.; Bota, S.A.; Segura, J. Leakage Power Characterization considering process variations. *Lecture Notes in Computer Science*. 4148, pp. 66 - 74. (Alemanya): 2006. ISSN 0302-9743
Tipus de producció: Artículo científico **Tipus de suport:** Revista
Nombre total d'autors: 4
- 30** Cano, X.; Graciani, R.; Gascón, D.; Garrido, L.; Bota, S.A.; Herms, A.; Comerma, A.; Riera, J. Radiation hardness on very front-end for SPD. *Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section A-Accelerators Spectrometers Detectors and Associated Equipment*. 551, pp. 458 - 468. (Holanda): 2005. ISSN 0168-9002
DOI: <https://doi.org/10.1016/j.nima.2005.06.043>
Tipus de producció: Artículo científico **Tipus de suport:** Revista
Nombre total d'autors: 8
Font d'impacte: ISI **Categoria:** INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION
Índex d'impacte: 1.224 **Revista dins del 25%:** No
Posició de publicació: 14 **Nombre de revistes a la categoria:** 52
Font d'impacte: ISI **Categoria:** NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY
Índex d'impacte: 1.224 **Revista dins del 25%:** Sí
Posició de publicació: 4 **Nombre de revistes a la categoria:** 32
Font d'impacte: ISI **Categoria:** PHYSICS, PARTICLES & FIELDS
Índex d'impacte: 1.224 **Revista dins del 25%:** No
Posició de publicació: 15 **Nombre de revistes a la categoria:** 21
Font d'impacte: ISI **Categoria:** SPECTROSCOPY
Índex d'impacte: 1.224 **Revista dins del 25%:** No
Posició de publicació: 27 **Nombre de revistes a la categoria:** 41
- 31** Rosselló, J.; Bota, S.A.; Segura, J. Compact static power model of complex CMOS gates. *Lecture Notes in Computer Science*. 3728, pp. 348 - 354. (Alemanya): 2005. ISSN 0302-9743
Tipus de producció: Artículo científico **Tipus de suport:** Revista
Nombre total d'autors: 4

**Font d'impacte:** ISI**Índex d'impacte:** 0.402**Posició de publicació:** 62**Categoria:** COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS**Revista dins del 25%:** No**Nombre de revistes a la categoria:** 71

- 32** B. Alorda; G. Torrens; S. Bota. 6T CMOS SRAM Stability in nanoelectronic Era: from metrics to built-in monitoring. Complementary Metal-oxide-semiconductor. (Croàcia): InTechOpen, 2018.
Tipus de producció: Capítulo de libro **Tipus de suport:** Llibre
Nombre total d'autors: 3
- 33** Bota, S.; Roca, M.; Isern, E.; others. EMC Modeling: An overview of emission and immunity phenomena modeling ICs. Electromagnetic Compatibility of Integrated Circuits. Sonia Ben Dhia, Mohamed Ramdani, Etienne Sicard Eds.pp. 286 - 294. New York(Estats Units d'Amèrica): Springer, 2006. ISBN 0-387-26600-3
Tipus de producció: Capítulo de libro **Tipus de suport:** Llibre

Treballs presentats en congressos nacionals o internacionals

- 1** **Títol del treball:** Chaotic signal generation in the MHz range with a monolithic CMOS-MEMS microbeam resonator
Nom del congrés: The 32nd IEEE International Conference on Micro Electro Mechanical Systems (MEMS 2019)
Tipus d'esdeveniment: Congrés **Àmbit del congrés:** Internacional
Tipus de participació: Participatiu - Póster
Ciutat de celebració: Seoul, República de Corea
Data de celebració: 2019
Data de finalització: 2019
Entitat organitzadora: IEEE
 J. Barceló; Ivan de Paúl; S. Bota; J. Segura; J. Verd. "IEEE Xplore".
- 2** **Títol del treball:** Weak and Strong SRAM cells analysis in embedded memories for PUF applications.
Nom del congrés: DCIS 2019
Tipus d'esdeveniment: Congrés **Àmbit del congrés:** Internacional
Tipus de participació: Participatiu - Ponència oral (comunicación oral)
Ciutat de celebració: Espanya
Data de celebració: 2019
Data de finalització: 2019
 Abdel ALheyasat; Gabriel Torrens; Sebastià Bota; Bartomeu Alorda.
- 3** **Títol del treball:** Development of a bistable CMOS-MEMS microbeam resonator with electrostatic actuation
Nom del congrés: The 31st IEEE International Conference on Micro Electro Mechanical Systems, MEMS 2018
Tipus d'esdeveniment: Congrés **Àmbit del congrés:** Internacional
Tipus de participació: Participatiu - Póster
Ciutat de celebració: Belfast, Regne Unit
Data de celebració: 2018
Data de finalització: 2018
Entitat organitzadora: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) **Tipus d'entitat:** Universitat
 J. Barceló; S. Bota; J. Segura; J. Verd.

- 4** **Títol del treball:** Design issues for NEM-Relay-based SRAM devices
Nom del congrés: 22nd International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC 2018)
Tipus d'esdeveniment: Congrés **Àmbit del congrés:** Internacional
Tipus de participació: Participativo - Ponencia oral (comunicación oral)
Ciutat de celebració: Palma, Espanya
Data de celebració: 2018
Data de finalització: 2018
Entitat organitzadora: Technical University of Sofia **Tipus d'entitat:** Universitat
Sebastià A. Bota; Jaume Verd; Xavier Gili; Joan Barceló; Gabriel Torrens; Rafel Perelló; Tomeu Alorda; Carol de Benito; Jaume Segura. "MATEC Web Conf., 210 (2018) 01005 DOI: <https://doi.org/10.1051/matecconf/201821001005>".
- 5** **Títol del treball:** Frequency Fluctuations in CMOS-MEMS Oscillators: Towards the Thermomechanical Limit
Nom del congrés: IEEE International Symposium on Circuits and Systems 2018
Tipus d'esdeveniment: Congrés **Àmbit del congrés:** Internacional
Tipus de participació: Participativo - Póster
Ciutat de celebració: Florence, Itàlia
Data de celebració: 2018
Data de finalització: 2018
Entitat organitzadora: IEEE
R. Perelló-Roig; J. Verd; S. Bota; J. Segura. "Proceedings".
- 6** **Títol del treball:** Bistability in a CMOS-MEMS Thermally Tuned Microbeam Resonator
Nom del congrés: IEEE International Symposium on Circuits and Systems 2018
Tipus d'esdeveniment: Congrés **Àmbit del congrés:** Internacional
Tipus de participació: Participativo - Ponencia oral (comunicación oral)
Ciutat de celebració: Florence, Itàlia
Data de celebració: 2018
Data de finalització: 2018
Entitat organitzadora: IEEE
J. Barceló; I. De Paul; S. Bota; J. Segura; J. Verd. "Proceedings".
- 7** **Títol del treball:** Cantilever NEMS relay-based SRAM devices for enhanced reliability
Nom del congrés: 12th IEEE International Conference on Design & Technology of Integrated Systems In Nanoscale Era (DTIS)
Tipus d'esdeveniment: Congrés **Àmbit del congrés:** Internacional
Tipus de participació: Participativo - Ponencia oral (comunicación oral)
Ciutat de celebració: Palma de Mallorca, Espanya
Data de celebració: 2017
Data de finalització: 2017
Entitat organitzadora: Universidad de las Islas **Tipus d'entitat:** Universitat
Baleares
Bota, S. A.; Verd, J.; Barceló, J.; Gili, X.; Alorda, B.; Torrens, G.; De Benito, C.; Segura, J. "DOI: 10.1109/DTIS.2017.7930177. pp. 1-6".
- 8** **Títol del treball:** Noise-matching in fully monolithic CMOS-MEMS oscillators for ultrasensitive mass sensing
Nom del congrés: XXXII Design of Circuits and Integrated Systems Conference (DCIS)
Tipus d'esdeveniment: Congrés **Àmbit del congrés:** Nacional
Tipus de participació: Participativo - Ponencia oral (comunicación oral)
Ciutat de celebració: Barcelona, Espanya



Data de celebració: 2017

Data de finalització: 2017

Entitat organitzadora: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Tipus d'entitat: Universitat

R. Perello-Roig; J. Verd; S. Bota; J. Segura.

9 **Títol del treball:** Experimental validation of bistability in an electrostatically actuated microbeam resonator with thermal tuning

Nom del congrés: 28th Micromechanics and Microsystems Europe workshop (MME2017)

Tipus d'esdeveniment: Congrés

Àmbit del congrés: Internacional

Tipus de participació: Participatiu - Pòster

Ciutat de celebració: Uppsala, Suècia

Data de celebració: 2017

Data de finalització: 2017

Barceló, J.; de Paul, I.; Bota, S.; Segura, J.; Verd, J.

10 **Títol del treball:** Nonlinear CC-beam Resonator Model for System Level Electrical Simulations

Nom del congrés: XXXI Design of Circuits and Integrated Systems Conference (DCIS 2016)

Tipus d'esdeveniment: Congrés

Àmbit del congrés: Internacional

Tipus de participació: Participatiu - Ponència oral (comunicació oral)

Ciutat de celebració: Granada, Espanya

Data de celebració: 2016

Data de finalització: 2016

Entitat organitzadora: Universidad de Granada

Tipus d'entitat: Universitat

Joan Barceló; Jaume Segura; Sebastià Bota; Jaume Verd.

11 **Títol del treball:** Monolithic CMOS-MEMS Capacitive Plate Resonator as a Low-Cost Platform for High-Resolution Distributed Mass Detection

Nom del congrés: XXXI Design of Circuits and Integrated Systems Conference (DCIS 2016)

Tipus d'esdeveniment: Congrés

Àmbit del congrés: Internacional

Tipus de participació: Participatiu - Ponència oral (comunicació oral)

Ciutat de celebració: Granada, Espanya

Data de celebració: 2016

Data de finalització: 2016

Entitat organitzadora: Universidad de Granada

Tipus d'entitat: Universitat

Jaume Verd; Rafel Perelló-Roig; Sebastià Bota; Joan Barceló; Jaume Segura.

12 **Títol del treball:** A sub-1mW Tunable-gain Transimpedance Amplifier for CMOS-MEMS Resonators

Nom del congrés: XXXI Design of Circuits and Integrated Systems Conference (DCIS 2016)

Tipus d'esdeveniment: Congrés

Àmbit del congrés: Internacional

Tipus de participació: Participatiu - Ponència oral (comunicació oral)

Ciutat de celebració: Granada, Espanya

Data de celebració: 2016

Data de finalització: 2016

Entitat organitzadora: Universidad de Granada

Tipus d'entitat: Universitat

Jaume Verd; Sebastià Bota; Fernando Rodríguez-Saavedra; Xavier Gili; Jaume Segura.

13 **Títol del treball:** On-line write margin estimator to monitor performance degradation in SRAM cores

Nom del congrés: IEEE 22nd International Symposium on On-Line Testing and Robust System Design

Tipus d'esdeveniment: Congrés

Àmbit del congrés: Internacional

Tipus de participació: Participatiu - Ponència oral (comunicació oral)



Ciutat de celebració: Catalunya, Espanya

Data de celebració: 2016

Data de finalització: 2016

Entitat organitzadora: IEEE

B. Alorda; C. Carmona; G. Torrens; S. Bota. "10.1109/IOLTS.2016.7604678".

14 Títol del treball: Radiation Effects in nanometric SRAMs induced by 18 MeV Protons

Nom del congrés: 10th Spanish Conference on Electron Devices

Tipus d'esdeveniment: Congrés

Àmbit del congrés: Nacional

Tipus de participació: Participativo - Póster

Ciutat de celebració: Aranjuez, Espanya

Data de celebració: 2015

Data de finalització: 2015

Entitat organitzadora: Universidad Rey Juan Carlos

Malagón Periañez, D.; Merino, J.L.; Torrens, G.; Segura, J.; Bota, S.A.; Jiménez-Ramos, M.C.; García López, J.

15 Títol del treball: Single Event Transients Generation in Silicon Devices with Pulsed Laser. A comparative Study

Nom del congrés: 10th Spanish Conference on Electron Devices

Tipus d'esdeveniment: Congrés

Àmbit del congrés: Nacional

Tipus de participació: Participativo - Póster

Ciutat de celebració: Aranjuez, Espanya

Data de celebració: 2015

Data de finalització: 2015

Entitat organitzadora: Universidad Rey Juan Carlos

De Paul, I.; Bandi, F.; Segura, J.; Bota, S. A.

16 Títol del treball: Towards an On-Chip MEMS Chaotic Generator in a Commercial 0.35-Micron CMOS Technology

Nom del congrés: 26th Micromechanics and Microsystems Europe workshop (MME 2015)

Tipus d'esdeveniment: Congrés

Àmbit del congrés: Internacional

Tipus de participació: Participativo - Póster

Ciutat de celebració: Toledo, Espanya

Data de celebració: 2015

Data de finalització: 2015

Entitat organitzadora: Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM)

Tipus d'entitat: Universitat

Barcelo, J.; Bota, S.; Segura, J.; Verd, J.

17 Títol del treball: Impact of increasing the fin height on soft error rate and static noise margin in a FinFET-based SRAM cell

Nom del congrés: 16th Latin-American Test Symposium (LATS)

Tipus d'esdeveniment: Congrés

Àmbit del congrés: Internacional

Tipus de participació: Participativo - Ponencia oral (comunicación oral)

Ciutat de celebració: Puerto Vallarta, Mèxic

Data de celebració: 2015

Data de finalització: 2015

Entitat organitzadora: Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM)

Tipus d'entitat: Universitat

Villacorta, H.; Gomez, R.; Bota, S.; Segura, J.; Champac, V."doi: 10.1109/LATW.2015.7102516".

- 18** **Títol del treball:** Design of a monolithic CMOS-MEMS resonator as chaotic signal generator.
Nom del congrés: DCIS 2014 (Conference on Design of Circuits and Integrated Systems).
Tipus d'esdeveniment: Congrés **Àmbit del congrés:** Internacional
Tipus de participació: Participativo - Ponencia oral (comunicación oral)
Ciutat de celebració: Madrid, Espanya
Data de celebració: 2014
Data de finalització: 2014
Entitat organitzadora: IEEE
Barceló, J.; Segura, J.; Bota, S.; Verd, J.
- 19** **Títol del treball:** Analysis of Fin Height on FinFET SRAM Cell Hardening
Nom del congrés: IEEE 57 Midwest Symposium on Circuits and Systems
Tipus d'esdeveniment: Congrés **Àmbit del congrés:** Internacional
Tipus de participació: Participativo - Ponencia oral (comunicación oral)
Ciutat de celebració: Texas, Estats Units d'Amèrica
Data de celebració: 2014
Data de finalització: 2014
Entitat organitzadora: IEEE
Villacorta, H.; Champac, V.; Segura, J.; Bota, S. "2014 IEEE 57th International Midwest Symposium on Circuits and Systems (MWSCAS) , vol., no., pp.671,674, 3-6 Aug. 2014 doi: 10.1109/MWSCAS.2014.6908504".
- 20** **Títol del treball:** Automated exhaustive exploration of SET pulse propagation in nanometer ICs through CAD analysis
Nom del congrés: XXIX Conference on Design of Circuits and Integrated Systems (DCIS)
Tipus d'esdeveniment: Congrés **Àmbit del congrés:** Internacional
Tipus de participació: Participativo - Ponencia oral (comunicación oral)
Ciutat de celebració: Madrid, Espanya
Data de celebració: 2014
Data de finalització: 2014
Barceló, S.; Gili, X.; Bota, S.A.; Segura, J.
- 21** **Títol del treball:** Latch SET capture in nanometer CMOS ICs: a detailed analysis
Nom del congrés: XXIX Conference on Design of Circuits and Integrated Systems (DCIS)
Tipus d'esdeveniment: Congrés **Àmbit del congrés:** Internacional
Tipus de participació: Participativo - Ponencia oral (comunicación oral)
Ciutat de celebració: Madrid, Espanya
Data de celebració: 2014
Data de finalització: 2014
Gili, X.; Barceló, S.; Bota, S.A.; Segura, J.
- 22** **Títol del treball:** Fully digital standard-cell based temperature sensor tolerant to supply voltage variability
Nom del congrés: XIX Conference on Design of Circuits and Integrated Systems (DCIS)
Tipus d'esdeveniment: Congrés **Àmbit del congrés:** Internacional
Tipus de participació: Participativo - Ponencia oral (comunicación oral)
Ciutat de celebració: Madrid, Espanya
Data de celebració: 2014
Data de finalització: 2014
Entitat organitzadora: Universidad Politécnica de Madrid **Tipus d'entitat:** Universitat

de Paúl, I.; de Benito, C.; Bota, S.A.; Segura, J.

- 23** **Títol del treball:** Word-line power supply selector for stability improvement of embedded SRAMs in high reliability applications
Nom del congrés: Design, Automation & Test in Europe (DATE'14)
Tipus d'esdeveniment: Congrés **Àmbit del congrés:** Internacional
Tipus de participació: Participativo - Ponencia oral (comunicación oral)
Ciutat de celebració: Dresden, Alemanya
Data de celebració: 2014
Data de finalització: 2014
Alorda, B.; Carmona, C.; Bota, S."DATE '14 Proceedings of the conference on Design, Automation & Test in Europe. Article No. 161, pp 1-6. doi: 10.7873/DATE.2014.174."
- 24** **Títol del treball:** Accurate alpha Soft error rate evaluation in SRAM memories
Nom del congrés: 19th IEEE International On-Line Symposium (IOLTS 2013)
Tipus d'esdeveniment: Congrés **Àmbit del congrés:** Internacional
Tipus de participació: Participativo - Ponencia oral (comunicación oral)
Ciutat de celebració: Chania, Grècia
Data de celebració: 2013
Data de finalització: 2013
Entitat organitzadora: University of Athens **Tipus d'entitat:** Universitat
Bota, S.; Torrens, G.; de Paul, I.; Alorda, B.; Segura, J."Proceedings of the 2013 IEEE 19th International On-Line Testing Symposium (IOLTS). pp 205-209. ISBN: 978-1-4799-0662-8. 2013."
- 25** **Títol del treball:** Top-Side Pulsed Laser Induced Single Event Upsets in Highly-Scaled SRAM Devices
Nom del congrés: Radiation Effects on Components and Systems: 2013 Conference (RADECS 2013)
Tipus d'esdeveniment: Congrés **Àmbit del congrés:** Internacional
Tipus de participació: Participativo - Póster
Ciutat de celebració: Oxford, Regne Unit
Data de celebració: 2013
Data de finalització: 2013
de Paúl, I.; Merino, J.L.; Torrens, G.; de Benito, C.; Verd, J.; Segura, J.; Bota, S.A."2013 14th European Conference on Radiation and Its Effects on Components and Systems (RADECS 2013) ISBN: 9781467350556 Published by Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). pp 438-441. DOI: 10.1109/RADECS.2013.6937413".
- 26** **Títol del treball:** FinFET SRAM hardening through design and technology parameters considering process variations
Nom del congrés: Radiation Effects on Components and Systems (RADECS) 2013
Tipus d'esdeveniment: Congrés **Àmbit del congrés:** Internacional
Tipus de participació: Participativo - Ponencia oral (comunicación oral)
Ciutat de celebració: Oxford, Regne Unit
Data de celebració: 2013
Data de finalització: 2013
Entitat organitzadora: IEEE
Villacorta, H.; Champac, V.; Bota, S.; Segura, J."2013 14th European Conference on Radiation and Its Effects on Components and Systems (RADECS 2013) ISBN: 9781467350556 Published by Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). pp. 35-41. DOI: 10.1109/RADECS.2013.6937372".
- 27** **Títol del treball:** Bridge defect detection in nanometer CMOS circuits using Low VDD and body bias
Nom del congrés: 14th Latin American Test Workshop 2013
Tipus d'esdeveniment: Congrés **Àmbit del congrés:** Internacional



Tipus de participació: Participativo - Ponencia oral (comunicación oral)

Ciutat de celebració: Cordoba, Argentina

Data de celebració: 2013

Data de finalització: 2013

Entitat organitzadora: IEEE

Villacorta, H.; Garcia-Gervacio, J.; Champac, V.; Bota, S.; Martinez, J.; Segura, J.

28 Títol del treball: An SET propagation EDA tool based on analytical glitch propagation model

Nom del congrés: Radiation Effects on Components and Systems 2013 (RADECS'13)

Tipus d'esdeveniment: Congrés

Àmbit del congrés: Internacional

Tipus de participació: Participativo - Póster

Ciutat de celebració: Oxford, Regne Unit

Data de celebració: 2013

Data de finalització: 2013

Entitat organitzadora: IEEE

Barceló, S.; Gili, X.; Bota, S.A.; Segura, J."2013 14th European Conference on Radiation and Its Effects on Components and Systems (RADECS 2013) ISBN: 9781467350556 Published by Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). pp 421 - 425. DOI: 10.1109/RADECS.2013.6937388".

29 Títol del treball: Alpha-SER determination from Word-line Voltage Margin (WVM) measurements: Design architecture and experimental results

Nom del congrés: Radiation Effects on Components and Systems 2013

Tipus d'esdeveniment: Congrés

Àmbit del congrés: Internacional

Tipus de participació: Participativo - Ponencia oral (comunicación oral)

Ciutat de celebració: Oxford, Regne Unit

Data de celebració: 2013

Data de finalització: 2013

Entitat organitzadora: Oxford University

Torrens, G.; de Paúl, I.; Alorda, B.; Bota, S.; Segura, J."Proceedings".

30 Títol del treball: Circuit reuse identification pre-processing tool for efficient CAD analysis

Nom del congrés: XVIII Conference on the Design of Circuits and Integrated Systems

Tipus d'esdeveniment: Congrés

Àmbit del congrés: Internacional

Tipus de participació: Participativo - Ponencia oral (comunicación oral)

Ciutat de celebració: Donostia - San Sebastian, Espanya

Data de celebració: 2013

Data de finalització: 2013

Barceló, S.; Gili, X.; Bota, S.A.; Segura, J.

31 Títol del treball: Analytical Critical Charge Description based on Memory Cell Dynamic Stability Analysis

Nom del congrés: XVIII Conference on the Design of Circuits and Integrated Systems (DCIS)

Tipus d'esdeveniment: Congrés

Àmbit del congrés: Internacional

Tipus de participació: Participativo - Ponencia oral (comunicación oral)

Ciutat de celebració: Donostia - San Sebastian, Espanya

Data de celebració: 2013

Data de finalització: 2013

Gili, X.; Barceló, S.; Bota, S.; Segura, J.

32 Títol del treball: Enhanced SRAM noise-susceptibility method based on energy analysis

Nom del congrés: Radiation effects on components and systems (RADECS)

Tipus d'esdeveniment: Congrés

Àmbit del congrés: Internacional



Tipus de participació: Participativo - Póster

Ciutat de celebració: Biarritz, França

Data de celebració: 2012

Data de finalització: 2012

Gili, X.; Barceló, S.; Bota, S.; Segura, J.

- 33** **Títol del treball:** Optimization of embedded 8T SRAMS usign Word-line voltage modulation
Nom del congrés: Design, Automation & Test in Europe (DATE'11)
Tipus d'esdeveniment: Congrés **Àmbit del congrés:** Internacional
Tipus de participació: Participativo - Ponencia oral (comunicación oral)
Ciutat de celebració: Grenoble, França
Data de celebració: 2011
Data de finalització: 2011
Alorda, B.; Torrens, G.; Bota, S.; Segura, J. "Proceedings of the 2011 Design, Automation & Test in Europe. ISBN: 978-3-9810801-7-9".
- 34** **Títol del treball:** An efficient and scalable STA tool with direct path estimation and exhaustive sensitization vector exploration for optimal delay computation
Nom del congrés: Conference on Design, Automation & Test in Europe (DATE'11)
Tipus d'esdeveniment: Congrés **Àmbit del congrés:** Internacional
Tipus de participació: Participativo - Ponencia oral (comunicación oral)
Ciutat de celebració: Grenoble, França
Data de celebració: 2011
Data de finalització: 2011
Barceló, S.; Gili, X.; Bota, S.; Segura, J.
- 35** **Títol del treball:** Analytical modeling of glitch propagation in nanometer ICs
Nom del congrés: SPIE Microtechnologies - VLSI Circuits and Systems Conference (SPIE 2011)
Tipus d'esdeveniment: Congrés **Àmbit del congrés:** Internacional
Tipus de participació: Participativo - Ponencia oral (comunicación oral)
Ciutat de celebració: Praga, República Txeca
Data de celebració: 2011
Data de finalització: 2011
Gili, X.; Barceló, S.; Bota, S.A.; Segura, J.
- 36** **Títol del treball:** Pass-Transistors pMOS based 8T SRAM cell for layout compaction
Nom del congrés: Spanish Conference on Electron Devices (CDE'11)
Tipus d'esdeveniment: Congrés **Àmbit del congrés:** Nacional
Tipus de participació: Participativo - Póster
Ciutat de celebració: Palma de Mallorca, Espanya
Data de celebració: 2011
Data de finalització: 2011
Bota, S.A.; Alorda, B.; Torrens, G.; Segura, J. "Digital Object Identifier: 10.1109/SCED.2011.5744184".
- 37** **Títol del treball:** Resistive Bridge Defect Detectability Considering Process Variation and Technology Scaling
Nom del congrés: 12th IEEE International Latin American Test Workshop
Tipus d'esdeveniment: Congrés **Àmbit del congrés:** Internacional
Tipus de participació: Participativo - Ponencia oral (comunicación oral)
Ciutat de celebració: Porto de Galinhas, Brasil
Data de celebració: 2011



Data de finalització: 2011

Entitat organitzadora: IEEE

Villacorta, H.; Champac, V.H.; Bota, S.A.; Segura, J.

- 38** **Títol del treball:** An analytical transfer function for SET propagation in nanometer CMOS ICs
Nom del congrés: Design of Circuits and Integrated Systems
Tipus d'esdeveniment: Congrés **Àmbit del congrés:** Internacional
Tipus de participació: Participativo - Ponencia oral (comunicación oral)
Ciutat de celebració: Albufeira, Portugal
Data de celebració: 2011
Data de finalització: 2011
Gili, X.; Barceló, S.; Bota, S.; Segura, J.
- 39** **Títol del treball:** Analytical modeling of Single Event Transients propagation in combinational logic gates
Nom del congrés: European Conference on Radiation and Its Effects on Components and Systems (RADECS), 2011 12th
Tipus d'esdeveniment: Congrés **Àmbit del congrés:** Internacional
Tipus de participació: Participativo - Ponencia oral (comunicación oral)
Ciutat de celebració: Sevilla, Espanya
Data de celebració: 2011
Data de finalització: 2011
Gili, X.; Barceló, S.; Bota, S.A.; Segura, J. "RADECS 2011 - Conference Proceedings pp 408 - 411 ISBN:978-1-4577-0587-8".
- 40** **Títol del treball:** Automatic SET propagation Tool based on analytical model
Nom del congrés: Design Automation Conference (DAC)
Tipus d'esdeveniment: Congrés **Àmbit del congrés:** Internacional
Tipus de participació: Participativo - Póster
Ciutat de celebració: San Diego, Estats Units d'Amèrica
Data de celebració: 2011
Data de finalització: 2011
Barceló, S.; Gili, X.; Bota, S.; Segura, J.
- 41** **Títol del treball:** Static and Dynamic Stability Improvement Strategies for 6T CMOS Low-Power SRAMs
Nom del congrés: Design, Automation and Test in Europe (DATE 2010)
Tipus d'esdeveniment: Congrés **Àmbit del congrés:** Internacional
Tipus de participació: Participativo - Ponencia oral (comunicación oral)
Ciutat de celebració: Dresden, Alemanya
Data de celebració: 2010
Data de finalització: 2010
Alorda, B.; Torrens, G.; Bota, S.; Segura, J. "Proceedings of Design, Automation and Test in Europe 2010. ISBN: 978-3-9810801-6-2".
- 42** **Títol del treball:** Cross-BIC architecture for single and multiple SEU detection enhancement in SRAM memories
Nom del congrés: IEEE 16th International On-Line Testing Symposium, 2010
Tipus d'esdeveniment: Congrés **Àmbit del congrés:** Internacional
Tipus de participació: Participativo - Ponencia oral (comunicación oral)
Ciutat de celebració: Corfú, Grècia
Data de celebració: 2010
Data de finalització: 2010



Bota, S.A.; Torrens, G.; Alorda, T.; Verd, J.; Segura, J. "Proceedings of the 2010 IEEE 16th International On-line Testing Symposium. ISBN: 978-1-4244-7721".

- 43** **Títol del treball:** Improving the Stability of 6T Embedded SRAMs Decreasing the Word-Line Voltage for High Reliability Applications
Nom del congrés: XXV Conference on Design of Circuits and Integrated Systems (DCIS 2010)
Tipus d'esdeveniment: Congrés **Àmbit del congrés:** Internacional
Tipus de participació: Participatiu - Ponència oral (comunicación oral)
Ciutat de celebració: Lanzarote, Espanya
Data de celebració: 2010
Data de finalització: 2010
Alorda, B.; Torrens, G.; Bota, S.; Segura, J. "Proceedings of the XXV Conference on Design of Circuits and Integrated Systems, pp 486-491. ISBN: 978-84-693-7393-4".
- 44** **Títol del treball:** Analytical delay temperature modeling for CMOS inverters base on dynamic threshold voltage modeling
Nom del congrés: XXV Conference on design of circuits and integrated Systems (DCIS'10)
Tipus d'esdeveniment: Congrés **Àmbit del congrés:** Internacional
Tipus de participació: Participatiu - Ponència oral (comunicación oral)
Ciutat de celebració: Lanzarote, Espanya
Data de celebració: 2010
Data de finalització: 2010
De Benito, C.; Rosselló, J.; Bota, S.; Segura, J.
- 45** **Títol del treball:** Implantación de mecanismos de evaluación y adquisición de competencias adaptadas al EEES a través de las prácticas: Experiencia en Instrumentación Electrónica Avanzada
Nom del congrés: XVIII Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas
Tipus d'esdeveniment: Congrés **Àmbit del congrés:** Nacional
Tipus de participació: Participatiu - Ponència oral (comunicación oral)
Ciutat de celebració: Santander, Espanya
Data de celebració: 2010
Data de finalització: 2010
Verd, J.; Alorda, B.; Canals, V.; Rosselló, J.L.; Segura, J.; Bota, S. "Proceedings del congreso".
- 46** **Títol del treball:** A Predictive Test Strategy for LNAs for RF CMOS receivers
Nom del congrés: The 15th Workshop on Synthesis And System Integration of Mixed Information technologies (SASIMI'09)
Tipus d'esdeveniment: Congrés **Àmbit del congrés:** Internacional
Tipus de participació: Participatiu - Póster
Ciutat de celebració: Okinawa, Japó
Data de celebració: 2009
Data de finalització: 2009
Suenaga, K.; Picos, R.; Bota, S.; Roca, M.; Isern, E.; García-Moreno, E. "Proceedings of the SASIMI'09".
- 47** **Títol del treball:** Predictive Test Technique for diagnosis of RF CMOS Receivers
Nom del congrés: IEEE VLSI Test Symposium (VTS)
Tipus d'esdeveniment: Congrés **Àmbit del congrés:** Internacional
Tipus de participació: Participatiu - Póster
Ciutat de celebració: Santa Cruz, California, Estats Units d'Amèrica
Data de celebració: 2009
Data de finalització: 2009



Suenaga, K.; Picos, R.; Bota, S.; Roca, M.; Isern, E.; García-Moreno, E. "Proceedings of the VTS'09".

48 Títol del treball: Analysis of Radiation Hardening Techniques for 6T SRAMs with Structured Layout

Nom del congrés: IEEE International Reliability Physics Symposium (IRPS) 2009

Tipus d'esdeveniment: Congrés

Àmbit del congrés: Internacional

Tipus de participació: Participatiu - Ponència oral (comunicación oral)

Ciutat de celebració: Montreal, Canadà

Data de celebració: 2009

Data de finalització: 2009

Torrens, G.; Alorda, B.; Rosselló, J.L.; Bota, S.; Segura, J. "Proceedings of the IEEE International Reliability Physics Symposium 2009. ISSN/ISBN: 1541-7026 / 978-1-4244-2888-5".

49 Títol del treball: Analysis of power-bus current transients in SRAM memories for single event upset detection

Nom del congrés: SPIE Europe - Microtechnologies for the New Millennium 2009

Tipus d'esdeveniment: Congrés

Àmbit del congrés: Internacional

Tipus de participació: Participatiu - Ponència oral (comunicación oral)

Ciutat de celebració: Dresden (4-6 May 2009), Alemanya

Data de celebració: 2009

Data de finalització: 2009

Torrens, G.; Bota, S.; Verd, J.; Alorda, B.; Merino, J.; Segura, J. "Proceedings of SPIE Volume 7363. ISSN / ISBN: 0277-786X / 9780819476371".

50 Títol del treball: A CMOS integrated system for SEE-Induced Transients Acquisition

Nom del congrés: 10th European Conference on Radiation Effects on Components and Systems (RADECS 2009)

Tipus d'esdeveniment: Congrés

Àmbit del congrés: Internacional

Tipus de participació: Participatiu - Pòster

Ciutat de celebració: Bruges, Bèlgica

Data de celebració: 2009

Data de finalització: 2009

Bota, S.; Merino, J.L.; Alorda, B.; Verd, J.; Torrens, G.; Segura, J.

51 Títol del treball: Critical Charge Characterization in 6-T SRAMs During Read Mode

Nom del congrés: 15th IEEE International OnLine Testing Symposium (IOLTS 2009)

Tipus d'esdeveniment: Congrés

Àmbit del congrés: Internacional

Tipus de participació: Participatiu - Ponència oral (comunicación oral)

Ciutat de celebració: Lisbon, Portugal

Data de celebració: 2009

Data de finalització: 2009

Bota, S.; Torrens, G.; Alorda, B.; Segura, J. "Proceedings of the 15th IEEE International OnLine Testing Symposium. ISBN: 978-1-4244-4822-7".

52 Títol del treball: Una iniciativa enfocada a la motivación del estudiante en los estudios técnicos: enginy@eps

Nom del congrés: 17 Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas, CUIEET09

Tipus d'esdeveniment: Congrés

Àmbit del congrés: Nacional

Tipus de participació: Participatiu - Ponència oral (comunicación oral)

Ciutat de celebració: València, Espanya

Data de celebració: 2009

Data de finalització: 2009



Entitat organitzadora: Universidad Politécnica de Valencia **Tipus d'entitat:** Administracions Públiques

Alorda, B.; Álvarez, M.J.; Barranco, M.; Bota, S.; Bonin-Font, F.; Burguera, A.; Carrasco, L.; Cladera, A.; Horrach, G.; Guerrero, J.; Llabrés, M.; Martínez, V.; Moià, A.; Payeras, M.; Picos, R.; Ramis, J.; Roca, M.; Rodríguez-Navas, G.; Rosselló, J.; Segura, J.; Suenaga, K.; Verd, J."Proceedings CUIEET 2009, ISBN: 978-84-613-4616-5".

- 53** **Títol del treball:** Static-Noise Margin Analysis during Read Operation of 6T SRAM Cells
Nom del congrés: XXIV Conference on Design of Circuits and Integratd Systems (DCIS 2009)
Tipus d'esdeveniment: Congrés **Àmbit del congrés:** Internacional
Tipus de participació: Participativo - Ponencia oral (comunicación oral)
Ciutat de celebració: Zaragoza, Espanya
Data de celebració: 2009
Data de finalització: 2009
 Alorda, B.; Torrens, G.; Bota, S.; Segura, J."Proceedings of the XXIV Conference on Design of Circuits and Integratd Systems."
- 54** **Títol del treball:** Parametrical fault test of CMOS LNA
Nom del congrés: 7th Int. Caribbean Conference on Devices Circuits and Systems, ICCDCS'08
Tipus d'esdeveniment: Congrés **Àmbit del congrés:** Internacional
Tipus de participació: Participativo - Ponencia oral (comunicación oral)
Ciutat de celebració: Cancún, Mèxic
Data de celebració: 2008
Data de finalització: 2008
 Suenaga, K.; Picos, R.; Bota, S.; Roca, M.; Isern, E.; García-Moreno, E."Proceedings of the ICCDCS'08".
- 55** **Títol del treball:** A Charge Estimation tool for Charge Based testing of Combinational CMOS ICs
Nom del congrés: XXIII Conference on Design of Circuits and Integrated Systems (DCIS'08)
Tipus d'esdeveniment: Congrés **Àmbit del congrés:** Internacional
Tipus de participació: Participativo - Ponencia oral (comunicación oral)
Ciutat de celebració: Grenoble, França
Data de celebració: 2008
Data de finalització: 2008
 Alorda, B.; Caubet, J.; Cañellas, M.; de Paúl, I.; Barceló, S.; Bota, S.; Segura, J."Comunicació a Congres".
- 56** **Títol del treball:** An SRAM SEU Hardening Technique for Multi-Vt Nanometric CMOS Technologies
Nom del congrés: XXIII Conference on Design of Circuits and Integrated Systems (DCIS 2008)
Tipus d'esdeveniment: Congrés **Àmbit del congrés:** Internacional
Tipus de participació: Participativo - Ponencia oral (comunicación oral)
Ciutat de celebració: Grenoble, França
Data de celebració: 2008
Data de finalització: 2008
 Torrens, G.; Alorda, B.; Barceló, S.; Rosselló, J.L.; Bota, S.A.; Segura, J."Proceedings of the XXIII Conference on Design of Circuits and Integrated Systems. ISBN: 978-2-84813-124-5".
- 57** **Títol del treball:** Heavy ion test results in a CMOS triple voting register for a high-energy physics experiment
Nom del congrés: 13th IEEE International on-line testing symposium
Tipus d'esdeveniment: Congrés **Àmbit del congrés:** Internacional
Tipus de participació: Participativo - Póster
Ciutat de celebració: Hersonissos, Grècia
Data de celebració: 2007

Data de finalització: 2007

Cano, X.; Bota, S.; Graciani, R.; Gascon, D.; Herms, A.; Comerma, A.; Segura, J.; Garrido, L. "Proceedings IOLTS 2007, pp 183-184."

58 Títol del treball: Dynamic Critical Resistance: A Timing-Based Critical Resistance Model for Statistical Delay Testing of Nanometer ICs (DATE'07)"

Nom del congrés: Design, Automation and Test in Europe 2007 DATE'07

Tipus d'esdeveniment: Congrés

Àmbit del congrés: Internacional

Tipus de participació: Participatiu - Ponència oral (comunicación oral)

Ciutat de celebració: Niza, França

Data de celebració: 2007

Data de finalització: 2007

Rosselló, J.L.; de Benito, C.; Bota, S.A.; Segura, J.

59 Títol del treball: Predictive Test Strategy for CMOS RF Mixers

Nom del congrés: 14th Workshop on Synthesis and System Integration of Mixed Information Technologies (SASIMI'07)

Tipus d'esdeveniment: Congrés

Àmbit del congrés: Internacional

Tipus de participació: Participatiu - Ponència oral (comunicación oral)

Ciutat de celebració: Hokkaido, Japó

Data de celebració: 2007

Data de finalització: 2007

Suenaga, K.; Picos, R.; Bota, S.; Roca, M.; Isern, E.; García-Moreno, E.

60 Títol del treball: Analysis of the influence of the Temperature in the Delay of multiple-input CMOS gates

Nom del congrés: VLSI Circuits and Systems. SPIE European Symposium on Microtechnologies for the New Millennium

Tipus d'esdeveniment: Congrés

Àmbit del congrés: Internacional

Tipus de participació: Participatiu - Ponència oral (comunicación oral)

Ciutat de celebració: Maspalomas, Espanya

Data de celebració: 2007

Data de finalització: 2007

De Benito, C.; Bota, S.A.; Rosselló, J.L.; Segura, J. "Proc. of SPIE Vol. 6590, 8 pág. , (2007)".

61 Títol del treball: Low-cost Built-In self test for system-on-chip RF receivers

Nom del congrés: XXII Conference on Design of Circuits and Integrated Systems. DCIS'07

Tipus d'esdeveniment: Congrés

Àmbit del congrés: Internacional

Tipus de participació: Participatiu - Ponència oral (comunicación oral)

Ciutat de celebració: Sevilla, Espanya

Data de celebració: 2007

Data de finalització: 2007

Suenaga, K.; Roca, M.; Isern, E.; Picos, R.; Bota, S. i Garcia-Moreno, E.

62 Títol del treball: A bulk-controlled low-voltage CMOS quadrature oscillator

Nom del congrés: XXII Conference on Design of Circuits and Integrated Systems. DCIS'07

Tipus d'esdeveniment: Congrés

Àmbit del congrés: Internacional

Tipus de participació: Participatiu - Ponència oral (comunicación oral)

Ciutat de celebració: Sevilla, Espanya

Data de celebració: 2007

Data de finalització: 2007

Picos, R.; Calaf, M.A.; Suenaga, K.; Bota, S.; Roca, M.; Isern, E.; i Garcia-Moreno, E.



- 63** **Títol del treball:** (Membre del comitè de programa)
Nom del congrés: Microtechnologies for the New Millennium 2007: VLSI Circuits and Systems.
Tipus d'esdeveniment: Congrés **Àmbit del congrés:** Internacional
Tipus de participació: Participativo - Otros
Ciutat de celebració: Maspalomas, Espanya
Data de celebració: 2007
Data de finalització: 2007
S.A. Bota.
- 64** **Títol del treball:** From Nuclear Reaction to system failure: Can we address all levels of soft errors accurately? (Taula rodona)
Nom del congrés: 12th IEEE Int. On-Line Testing Symposium (IOLTS 2006)
Tipus d'esdeveniment: Congrés **Àmbit del congrés:** Internacional
Tipus de participació: Participativo - Otros
Ciutat de celebració: Como, Itàlia
Data de celebració: 2006
Data de finalització: 2006
Alexandrescu, D.; Anghel, L.; Bota, S.; Buard, N.; Lopez, C.; Nieuwland, A.; Renaud, N.
- 65** **Títol del treball:** The Front End Electronics of the Scintillator Pad Detector of the LHCb Calorimeter
Nom del congrés: 12th Workshop on Electronics for LHC and Future Experiments
Tipus d'esdeveniment: Congrés **Àmbit del congrés:** Internacional
Tipus de participació: Participativo - Ponencia oral (comunicación oral)
Ciutat de celebració: Valencia, Espanya
Data de celebració: 2006
Data de finalització: 2006
Abellan, C.; Bota, S.; Comerma, A.; Dieguez, A.; Garrido, L.; Gascon, D.; Gaspar, A.; Graciani, R.; Grauges, E.; Herms, A.; Llorens, M.; Luengo, S.; Picatoste, E.; Riera, J.; Ruiz, H.; Tortella, S.; Vilasis, X.
- 66** **Títol del treball:** Predictive oscillation based test of CMOS circuits
Nom del congrés: 6th International Caribbean Conference on Devices, Circuits and Systems. ICCDCS'06
Tipus d'esdeveniment: Congrés **Àmbit del congrés:** Internacional
Tipus de participació: Participativo - Ponencia oral (comunicación oral)
Ciutat de celebració: Playa del Carmen, Mèxic
Data de celebració: 2006
Data de finalització: 2006
Suenaga, K.; Isern, E.; Picos, R.; Bota, S.A.; Roca, M. i García-Moreno, E.
- 67** **Títol del treball:** Fault Detection and parameter Prediction of an OpAmp using a Charge Monitor
Nom del congrés: 6th International Caribbean Conference on Devices, Circuits and Systems, ICCDCS'06
Tipus d'esdeveniment: Congrés **Àmbit del congrés:** Internacional
Tipus de participació: Participativo - Ponencia oral (comunicación oral)
Ciutat de celebració: Playa del Carmen, Mèxic
Data de celebració: 2006
Data de finalització: 2006
Picos, R.; Roca, M.; Isern, E.; Bota, S.; García-Moreno, E. "Proceedings of the ICCDCS'06".
- 68** **Títol del treball:** Compact Frequency Offset Circuit for Testing IC RF Transceivers
Nom del congrés: 8th Int. Conference on Solid-State and Integrated-Circuit Technology
Tipus d'esdeveniment: Congrés **Àmbit del congrés:** Internacional



Tipus de participació: Participatiu - Ponencia oral (comunicació oral)
Ciutat de celebració: Shangai, Xina
Data de celebració: 2006
Data de finalització: 2006
Garcia-Moreno, E.; Suenaga, K.; Picos, R.; Bota, S.; Roca, M.; Isern, E.

69 Títol del treball: Fault diagnosis approach by using oscillation test techniques in an operational transconductance amplifier

Nom del congrés: IEEE International Mixed-Signal Test Workshop

Tipus d'esdeveniment: Congrés

Àmbit del congrés: Internacional

Tipus de participació: Participatiu - Ponencia oral (comunicació oral)

Ciutat de celebració: Edimburg, Regne Unit

Data de celebració: 2006

Data de finalització: 2006

Picos, R.; Roca, M.; Isern, E.; Bota, S. i García-Moreno, E.

70 Títol del treball: A Fully CMOS Low-Cost Chaotic Neural Network

Nom del congrés: Internacional Joint Conference on Neural Networks, 2006. IJCNN '06.

Tipus d'esdeveniment: Congrés

Àmbit del congrés: Internacional

Tipus de participació: Participatiu - Ponencia oral (comunicació oral)

Ciutat de celebració: Vancouver, Canadà

Data de celebració: 2006

Data de finalització: 2006

Rossello, J.L.; Bota, S.; Canals, V.; de Paul, I.; Segura, J.

71 Títol del treball: Leakage power characterization considering process variations

Nom del congrés: International Workshop of Power and Timing Modeling. Optimization and Simulation. PATMOS'06

Tipus d'esdeveniment: Congrés

Àmbit del congrés: Internacional

Tipus de participació: Participatiu - Ponencia oral (comunicació oral)

Ciutat de celebració: Montpelier, França

Data de celebració: 2006

Data de finalització: 2006

Rosselló, J.L.; De Benito, C.; Bota, S.; Segura, J. "Proceedings of International Workshop of Power and Timing Modeling. Optimization and Simulation. PATMOS'06".

72 Títol del treball: Temperatura-delay analysis of multiple input CMOS gates

Nom del congrés: XXI Conference on Design of Circuits and Integrated Systems (DCIS2006)

Tipus d'esdeveniment: Congrés

Àmbit del congrés: Internacional

Tipus de participació: Participatiu - Ponencia oral (comunicació oral)

Ciutat de celebració: Barcelona, Espanya

Data de celebració: 2006

Data de finalització: 2006

De Benito, C.; Bota, S.A.; Rosselló, J.L.; Segura, J. "Proceedings of Design of Circuits and Integrated Systems Conference. (DCIS2006)".

73 Títol del treball: Low Vdd vs delay: is it really a good correlation metric for nanometer ICs?

Nom del congrés: IEEE VLSI Test Symposium (VTS'06)

Tipus d'esdeveniment: Congrés

Àmbit del congrés: Internacional

Tipus de participació: Participatiu - Ponencia oral (comunicació oral)

Ciutat de celebració: Berkeley, CA, Estats Units d'Amèrica



Data de celebració: 2006

Data de finalització: 2006

Bota, S.; Rosales, M.; Rosselló, J.L.; Segura, J.

74 **Títol del treball:** Parameter Prediction in Analog Circuits by Using Non-Linear Oscillation Techniques

Nom del congrés: XXI Conference on Design of Circuits and Integrated Systems. DCIS'06

Tipus d'esdeveniment: Congrés

Àmbit del congrés: Internacional

Tipus de participació: Participativo - Ponencia oral (comunicación oral)

Ciutat de celebració: Barcelona, Espanya

Data de celebració: 2006

Data de finalització: 2006

Isern, E.; Roca, M.; Picos, R.; Bota, S.; Suenaga, K. i García-Moreno, E.

75 **Títol del treball:** Built-in Self Methodology for CMOS RF Receivers

Nom del congrés: XXI Conference on Design of Circuits and Integrated Systems. DCIS'06

Tipus d'esdeveniment: Congrés

Àmbit del congrés: Internacional

Tipus de participació: Participativo - Ponencia oral (comunicación oral)

Ciutat de celebració: Barcelona, Espanya

Data de celebració: 2006

Data de finalització: 2006

Suenaga, K.; Picos, R.; Bota, S.; Roca, M.; Isern, E. i García-Moreno, E.

76 **Títol del treball:** Analysis of the rejection of power supply interference in fully differential circuits

Nom del congrés: XXI Conference on Design of Circuits and Integrated Systems. DCIS'06

Tipus d'esdeveniment: Congrés

Àmbit del congrés: Internacional

Tipus de participació: Participativo - Ponencia oral (comunicación oral)

Ciutat de celebració: Barcelona, Espanya

Data de celebració: 2006

Data de finalització: 2006

Gascón, D.; Diéguez, A.; Bota, S.; Garrido, L.

77 **Títol del treball:** session: Thermal modeling of devices circuits and systems (Presidència de sessió)

Nom del congrés: XXI Conference on Design of Circuits and Integrated Systems. DCIS'06

Tipus d'esdeveniment: Congrés

Àmbit del congrés: Internacional

Tipus de participació: Participativo - Otros

Ciutat de celebració: Barcelona, Espanya

Data de celebració: 2006

Data de finalització: 2006

S.A. Bota.

78 **Títol del treball:** A Non-intrusive Built-in sensor for transient current testing of digital VLSI circuits

Nom del congrés: 11th IEEE International On-Line testing symposium (IOLTS 2005)

Tipus d'esdeveniment: Congrés

Àmbit del congrés: Internacional

Tipus de participació: Participativo - Ponencia oral (comunicación oral)

Ciutat de celebració: Saint Rafael, França

Data de celebració: 2005

Data de finalització: 2005

Alorda, B.; Bota, S.A.; Segura, J. "Proceedings IOLTS 2005, pp 177-182, 2005 ISBN 0-7695-2406-0".

- 79** **Títol del treball:** Analysis of the impact of process variations on oscillations test methodologies
Nom del congrés: 11th International Mixed-Signals Testing Workshop IMSTW'05
Tipus d'esdeveniment: Congrés **Àmbit del congrés:** Internacional
Tipus de participació: Participativo - Ponencia oral (comunicación oral)
Ciutat de celebració: Cannes, França
Data de celebració: 2005
Data de finalització: 2005
Picos, R.; Roca, M.; Bota, S.A.; Isern, E.; Suenaga, K.; Garcia-Moreno, E."pp 320-329".
- 80** **Títol del treball:** THERMAL-AWARE DESIGN RULES FOR NANOMETER ICS
Nom del congrés: 11th International Workshop on Thermal Investigation of ICs and systems. (THERMINIC 2005)
Tipus d'esdeveniment: Congrés **Àmbit del congrés:** Internacional
Tipus de participació: Participativo - Ponencia oral (comunicación oral)
Ciutat de celebració: Belgirate (Lago Mayor), Itàlia
Data de celebració: 2005
Data de finalització: 2005
J-L. Rosselló; S.Bota; M. Rosales; A. Keshavarzi; J. Segura. "Collection of Papers presented at 11th International Workshop on Thermal Investigation of ICs and systems. pp 2-6. 2005".
- 81** **Títol del treball:** Smart Temperature Sensor for Thermal Testing of Cell-Based ICs
Nom del congrés: Design, Automation and Test in Europe 2005
Tipus d'esdeveniment: Congrés **Àmbit del congrés:** Internacional
Tipus de participació: Participativo - Ponencia oral (comunicación oral)
Ciutat de celebració: Munich, Alemanya
Data de celebració: 2005
Data de finalització: 2005
S.A. Bota; M. Rosales; J.L. Rosselló; J. Segura.
- 82** **Títol del treball:** A Fast Concurrent Power-Thermal Model for Sub-100nm Digital ICs
Nom del congrés: Design, Automation and Test in Europe 2005
Tipus d'esdeveniment: Congrés **Àmbit del congrés:** Internacional
Tipus de participació: Participativo - Ponencia oral (comunicación oral)
Ciutat de celebració: Munich, Alemanya
Data de celebració: 2005
Data de finalització: 2005
J.L. Rosselló; V. Canals; S.A. Bota; A. Keshavarzi; J. Segura.
- 83** **Títol del treball:** Compact Static Power Model of Complex CMOS Gates
Nom del congrés: PATMOS 2005
Tipus d'esdeveniment: Congrés **Àmbit del congrés:** Internacional
Tipus de participació: Participativo - Ponencia oral (comunicación oral)
Ciutat de celebració: Leuven, Bèlgica
Data de celebració: 2005
Data de finalització: 2005
Rosselló, J.L.; Bota, S.A.; Segura, J."LNCS 3728, Ed. Springer Verlag, pp 348-354, 2005".
- 84** **Títol del treball:** Experimental comparison of different oscillation-based test techniques in an analog block
Nom del congrés: SPIE's International Symposium on Microtechnologies for the New Millenium 2005
Tipus d'esdeveniment: Congrés **Àmbit del congrés:** Internacional
Tipus de participació: Participativo - Ponencia oral (comunicación oral)



Ciutat de celebració: Sevilla, Espanya

Data de celebració: 2005

Data de finalització: 2005

K. Suenaga; R. Picos; S.A. Bota; M. Roca; E. García-Moreno.

85 **Títol del treball:** Temperature effects on circuit synchronism

Nom del congrés: VLSI circuits and systems II

Tipus d'esdeveniment: Congrés

Àmbit del congrés: Internacional

Tipus de participació: Participativo - Ponencia oral (comunicación oral)

Ciutat de celebració: Sevilla, Espanya

Data de celebració: 2005

Data de finalització: 2005

Bota, S.A.; Segura, J.; Rosselló, J.L.; Rosales, M. "Proceedings of SPIE vol.5837, pp 349-358, 2005 ISBN 0-8194-5832-5".

86 **Títol del treball:** Built-in Test Strategy for CMOS RF Mixers

Nom del congrés: XX Conference on design of circuits and Integrated Systems (DCIS 2005)

Tipus d'esdeveniment: Congrés

Àmbit del congrés: Internacional

Tipus de participació: Participativo - Ponencia oral (comunicación oral)

Ciutat de celebració: Lisboa, Portugal

Data de celebració: 2005

Data de finalització: 2005

Suenaga, K.; Picos, R.; Bota, S.A.; Roca, M.; Isern, E.; García-Moreno, E. "Proceedings editados en CD-ROM".

87 **Títol del treball:** (Membre del comitè de programa)

Nom del congrés: Microtechnologies for the new millenium 2005: VLSI circuits and systems

Tipus d'esdeveniment: Congrés

Àmbit del congrés: Internacional

Tipus de participació: Participativo - Otros

Ciutat de celebració: Sevilla, Espanya

Data de celebració: 2005

Data de finalització: 2005

S.A: Bota.

Gestió d'R+D+i i participació en comitès científics

Comitès científics, tècnics i assessors

1 **Títol del comitè:** Tribunal de Tesis doctoral
Entitat d'afiliació: Universitat de Barcelona
Data d'inici-fi: 2010 - 2010

2 **Títol del comitè:** Tribunal de Tesis doctoral
Entitat d'afiliació: Universitat Ramon Llull
Data d'inici-fi: 2009 - 2009

3 **Títol del comitè:** Tribunal de Tesis doctoral
Entitat d'afiliació: Universitat Ramon Llull
Data d'inici-fi: 2009 - 2009



4 **Títol del comitè:** Comissió d'Elaboració i Disseny del nou Grau de Física
Entitat d'afiliació: Universidad de las Islas Baleares
Data d'inici-fi: 2008 - 2008

5 **Títol del comitè:** Tribunal de Tesis doctoral
Entitat d'afiliació: Universidad de las Islas Baleares
Data d'inici: 10/2015

6 **Títol del comitè:** Tribunal de Tesis doctoral
Entitat d'afiliació: Universidad de las Islas Baleares
Data d'inici: 2010

Altres mèrits

Resum d'altres mèrits

1 **Descripció del mèrit:** Trams de Recerca (sexennis): Evaluación positiva de 1 tramo de investigación realizada por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora
Data de la concessió: 01/01/2004

2 **Descripció del mèrit:** Línies de recerca: Diseño MIXTO; 1996 --
Entitat que acredita: Universitat de Barcelona
Data de la concessió: 1996

3 **Descripció del mèrit:** Línies de recerca: Diseño de Asics; 1994 --
Entitat que acredita: Universitat de Barcelona
Data de la concessió: 1994

4 **Descripció del mèrit:** Línies de recerca: Diseño de circuitos de interface para sensores ; 1994 --
Entitat que acredita: Universitat de Barcelona
Data de la concessió: 1994

5 **Descripció del mèrit:** Grans Equips que utilitza o ha utilitzat: Equipos de Test para la caracterización eléctrica de dispositivos microelectrónicos; Usuari assidu; 1988

6 **Descripció del mèrit:** - Álvarez, A.; Bota, S.; Burrer, Chr.; Campabadal, F.; Cané, C. ; Carrabina, J.; Demange, N.; Esteve, J.; Götz, A.; Lozano, M.; Marco, S.; Plaza, J.A.; Saiz, J. Santander, J. Primeros resultados del proceso de compatibilización Sensor de presión - CMOS. Nota técnica n 72/94 C.N.M Barcelona. 1994.